รหัสโครงการ SUT7-713-56-12-16



รายงานการวิจัย

พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

(Corrosion behavior of AISI 4140 surface coated by TiAlN)



ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

รหัสโครงการ SUT7-713-56-12-16



รายงานการวิจัย

พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

(Corrosion behavior of AISI 4140 surface coated by TiAlN)

คณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์
 2. คร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ผลงานวิจัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว

มีนาคม 2557

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เรื่อง "พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์" และ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียสละเวลา ทำหน้าที่ตรวจ ข้อเสนอโครงการ และตรวจร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์



พรวสา วงศ์ปัญญา มีนาคม 2557

บทคัดย่อ พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์

รายงานการวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้ำ AISI 4140 (A4140) และเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่เกลือบด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม- ในตรายด์ (TiAIN) ที่มีความ หนาของชั้นเคลือบ TiAIN แตกต่างกัน ที่ความหนา 250 นาโนเมตร (TiAIN-250nm) 500 นาโนเมตร (TiAIN-500nm) และ 750 นาโนเมตร (TiAIN-750nm) ในสารละลายที่เป็นสิ่งแวดล้อมการกัดกร่อนที่ มีค่าพีเอชต่างกัน ก่อนการทดสอบการกัดกร่อนทำการตรวจสอบคุณลักษณะของฟิล์ม TiAlN ด้วย เทกนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) และกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิคฟิลอิมิชชั่น (FE-SEM) และจากนั้นศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงาน A4140, TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAIN-750nm ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีค่าพีเอช 2. 7 และ 10 ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี หลังทดสอบการกัดกร่อนพื้นผิวของชิ้นงานถูกวิเคราะห์ด้วยกล้อง ้งลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM) และเทคนิค X-PEEM จากการวิจัยพบว่าชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI ่ 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วย TiAIN มีความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าที่ไม่ถูกเคลือบที่ ทกค่าพีเอช ความหนาของฟิล์ม TiAIN ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น เนื่องจากชิ้นงานที่เคลือบ TiAIN เกิดพาสสีฟฟิล์มที่มีความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีหรือมี เสถียรภาพสง จากการวิเคราะห์พื้นผิวที่เกิดการกัดกร่อนด้วยเทคนิค X-PEEM พบว่าชิ้นงานที่ถก เคลือบด้วยฟิล์ม TiAIN บางที่สุดเกิดการหลุดลอกของฟิล์มจากวัสดุพื้น นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นผิว ของชิ้นงานที่ถูกเคลือบด้วย TiAIN มีพื้นที่ถูกกัดกร่อนและปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่น้อยกว่า ชิ้นงาน A4140

Abstract

Corrosion behavior of AISI 4140 surface coated by TiAIN

This research aims to study the corrosion behavior of uncoated and TiAlN coated on AISI 4140 steel. The AISI 4140 steel samples were coated by TiAlN with various thicknesses, i.e., 250 nm (TiAlN-250nm), 500 nm (TiAlN-500nm) and 750 nm (TiAlN-750nm). After that samples surface was characterized by Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) with energy dispersive X-ray analysis (EDX) and X-ray diffraction (XRD). The corrosion behavior of the uncoated and coated samples were studied by an electrochemical technique in 3.5 wt% NaCl solution at pH value of 2, 7 and 10 at room temperature. After electrochemical testing, samples surface was characterized by scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive X-ray analysis (EDX) and X-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM) with X-ray absorption spectroscopy (XAS). The results indicated that the TiAlN coated samples yielded better corrosion resistance because the TiAlN coated samples had stable passive film. The results from corroded surface characterized by X-PEEM showed that there was a spalling of the film from metal substrate in particular for the thin coated sample. Moreover, it was found that the TiAlN coated samples.



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ป
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ป
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ค
สารบัญ	٩
สารบัญตาราง	R
สารบัญรูป	ୟ
บทที่1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ปริทรรศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 กระบวนการเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ	5
2.2 การกัดกร่อน	7
2.3 การวิเคราะห์ชั้นเคลือบ	11
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	16
3.1 วัสดุ และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	16
3.1.1 วัสคุพื้นที่ใช้ในการวิจัย	16
3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย	16
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำเนินการวิจัย	17
3.2.1 อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่างผิวก่อนการเคลือบ	17
3.2.2 อุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบผิว	20
3.2.3 อุปกรณ์สำหรับทดสอบการกัดกร่อน	22

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
3.2.4 อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบพื้นผิว	23
3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย	25
3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานก่อนเกลือบผิว	26
3.3.2 ขั้นตอนกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพ	28
3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวก่อนทคสอบการกัคกร่อน	30
3.3.4 ขั้นตอนการทคสอบการกัดกร่อน	30
3.3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวหลังทคสอบการกัดกร่อน	32
บทที่ 4 ผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย	33
4.1 ผลการตรวจสอบฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ ที่เคลือบ	
บนเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน	33
4.1.1 การวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคพื้นผิว และตามแนวภาคตัดขวางของ	
ฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ ที่เคลือบบน	
เหล็กกล้ำ AISI 4140 ค้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิคฟิลอิมิช	ชั้น
(FE-SEM)	33
4.1.2 การวิเคราะห์ฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ ที่เคลือบบน	l
เหล็กกล้ำ AISI 4140 ด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)	37
4.2 ผลการทดสอบการกัดกร่อน (กลุ่มเกลย (กล่อ	40
4.2.1 พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 และเหล็กกล้า AISI	[4140
ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์	44
4.2.2 พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 เคลือบผิวด้วย ไทเข	าเนียม-
อะลูมิเนียม-ในตรายค์ที่มีความหนาแตกต่างกัน	
(TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm)	44
4.2.3 ผลของค่าความเป็นกรด-ค่าง (pH)ของสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน	
ของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย	
ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์	47

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4.3 คุณลักษณะของชิ้นงานเหลีกกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์	
หลังทดสอบการกัดกรอน	50
4.3.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูก	
เกลือบผิว และชินงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิว	
ด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ หลังการทดสอบ	
การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ	
3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2,7 และ10	
ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)	50
4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเกมีบนพื้นผิวของชิ้นงานภายหลัง	
ทคสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค EDX	54
4.3.3 การวิเคราะห์ถักษณะผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าและชิ้นงานเหล็กกล้า	
AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์	
หลังการทคสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค X-PEEM	63
บทที่ 5 สรุป	69
บรรณานุกรม	71
ภาคผนวก ^{(อิ} กยาลัยเทคโนโลยีสุรัง	
ภาคผนวกก: แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS-card	75
ภาคผนวกข: การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า	
การกัดกร่อนและการคำนวณอัตราการกัดกร่อน	79
ภาคผนวก ค: ส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่	85
ประวัติคณะผู้วิจัย	97

ฉ

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	ส่วนผสมทางเกมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ของเหล็กกล้ำ AISI 4140	16
3.2	ค่าความแข็งของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน	26
3.3	ตัวแปรในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ (TiAIN)	
	ด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซี โคแมกนีตรอนสปัตเตอริง	28
3.4	ค่าความหนาของเคลือบผิวค้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์	30
4.1	เฟสองค์ประกอบของผิวเคลือบ	39
4.2	ค่าที่ได้จากเส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว	43
	(A4140) และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์ม	
	ใทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ (TiAlN-250nm TiAlN-500nm และ TiAlN-	
	750nm)ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนัก	
	ที่มีค่าพีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10	46
4.3	ส่วนผสมเคมีของชั้นเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ (at.%)	68
ก.1	JCPDS-card ของสารประกอบ TiAlN ₂ (Ti _{0.5} Al _{0.5} N)	76
ก.2	JCPDS-card ของสารประกอบ Fe	77
n.3	JCPDS-card ของสารประกอบ TiN	78

สารบัญรูป

รูป		หน้า
2.1	กลไกการทำ Sputtering	5
2.2	การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน	
	โดยเกรื่องโพเทนชิโอสแตท	8
2.3	ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	9
2.4	ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโพลาไรเซชัน	10
2.5	ระดับชั้นพลังงานของ XPS	11
3.1	สารเคมีสำหรับเตรียมผิวชิ้นงาน	17
3.2	เตาอบชิ้นงาน	18
3.3	เกรื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานหมุนยี่ห้อ BUEHLER	18
3.4	กระดาษทรายที่ใช้ในการขัดผิวชิ้นงาน	19
3.5	เครื่องวัดความแข็ง Rockwell Hardness Tester 660	19
3.6	ลักษณะ และใดอะแกรมของเครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัย	20
3.7	ลักษณะคาโทค การวางชิ้นงาน และพลาสมาขณะเคลือบ	21
3.8	เครื่องโพเทนชิโอสแตท	21
3.9	อิเล็กโทรคที่ใช้ในการทคสอบการกัคกร่อน	22
3.10	กล้องจุลทรรศน์ รุ่น BX51 Olympus High Power Microscope	23
3.11	กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิดฟิลอิมิชชั่น (FE-SEM)	24
3.12	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Photoemission electron microscopy	24
3.13	แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย	25
3.14	ชิ้นงานในงานวิจัย	26
3.15	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน	27
3.16	ขั้นตอนการวัคความหนาของชั้นเคลือบโดยอาศัยการเทียบแถบวัค (scale bar)	29
3.17	การติดตั้งชุดเซลการกัดกร่อน	31
3.18	การหาก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และก่ากวามหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	32
4.1	โครงสร้างจุลภาคพื้นผิว และภาคตัดขวางของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายเ	ค์ 34

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูป		หน้า
4.2	ภาพตัดขวางของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ใน	
	ตรายด์ (TiAlN-250nm TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm) วิเคราะห์ความแปรปรวน	
	ของส่วนผสมทางเคมีด้วยเทคนิก EDX	35
4.3	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ เคลือบบน	35
	ซิลิกอนเวเฟอร์	
4.4	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม TiAIN (TiAIN-250nm) ที่เคลือบบน	36
	เหล็กกล้ำ AISI 4140	
4.5	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ TiAIN (TiAIN-500nm)ที่เคลือบบนเหล็กกล้ำ AISI 4140	37
4.6	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ TiAIN (TiAIN-500nm)ที่เคลือบบนเหล็กกล้ำ AISI 4140	38
4.7	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140 TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ	38
	TiAIN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2	
4.8	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140 TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ	41
	TiAIN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่	
	ค่าพีเอช 7	
4.9	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140 TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ	41
	TiAIN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 10	
4.10	ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน TiAIN-250nm	42
	TiAIN-500nmและ TiAIN-750nm ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์	
	ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2, 7 และ 10	45
4.11	ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานของชิ้นงาน TiAlN-250nmTiAlN-500nm	
	และ TiAIN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้น	
	ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10	46
4.12	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่าง TiAIN-250nm ในสารละลาย	
	โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ10	47
4.13	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่าง TiAlN-500nm ในสารละลาย	
	โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ10	48

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

รูป

4.14	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่าง TiAlN-750nm ในสารละลาย	
	โซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ10	49
4.15	ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน A4140 และ TiAlN-250 nm หลังการทดสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มี	
	ค่าพีเอช 2, 7 และ10	51
4.16	ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-750 nm หลังการ	
	ทคสอบการกัคกร่อนในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคย	
	น้ำหนักที่มีค่าพีเอช 2, 7 และ10	52
4.17	ภาพถ่าย SEM ของชิ้นงาน TiAlN-250nm และ TiAlN-500nm หลังทคสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่า	
	พีเอช 2	53
4.18	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAlN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2	55
4.19	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAlN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ก่าพีเอช 7	56
4.20	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAlN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 10	57
4.21	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAlN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2	59
4.22	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAIN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 7	60
4.23	ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน	
	TiAIN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 10	61
4.24	พื้นผิวชิ้นงานหลังการทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่พีเอช 2	-
	ด้วยเทคนิค X-PEEM	62
4 25	สแโกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-500mm หลังการทดสอบการกัดกร่อบใบ	02
5	สารละลายที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิค XAS	64
		01

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูป		หน้า
4.26	สเปกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAlN-500nm หลังการทคสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิค XAS	65
4.27	สเปกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-750nm หลังการทคสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิค XAS	66
ข.1	การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	80
ข.2	การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	82
ข.3	การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	83



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

เหล็กกล้า AISI 4140 เป็นเหล็กกล้าผสมต่ำที่มีความแข็งแรงสูงและมีความสามารถในการ ้ขึ้นรูปทางกลได้ง่าย มีธาตุผสมหลัก คือ โครเมียม และ โมลิบดีนัม อยู่ในปริมาณที่ต่ำ จึงทำให้ เหล็กกล้า AISI 4140 มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าเครื่องมือชนิดอื่น เช่น H13 และ D2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเหล็กกล้าที่มีความต้านทานแรงคึงสูง สามารถทนแรงคึงได้ระหว่าง 800-1300 เมกะปาสกาล (MPa) สามารถชุบแข็งได้ทั้งชิ้นหรือเฉพาะที่ผิวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การ ใช้งาน นิยมทำเป็นชิ้นส่วนทนแรงดึงสูงเช่น ชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น เพลาข้อ ้เหวี่ยง เฟือง เฟืองขับ เกียร์ สลัก เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้งานในสภาวะที่ มีการเสียคสี (Abrasion) และการสึกหรอ (Wear) จึงต้องการความแข็งที่ผิวเพื่อป้องกันการเสียคสี และการสึกหรอที่ผิว แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องการกัดกร่อน(Corrosion) ที่เกิดจาก สภาพแวคล้อมการใช้งาน คังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติทางค้านพื้นผิวของวัสคุ ้เพื่อให้มีคุณสมบัติทางกลที่ดีขึ้นและมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของวัสคุให้ยาวนานยิ่งขึ้น การปรับปรุงพื้นผิววัสคุให้มีความต้านทานการ ้กัดกร่อนที่ดีขึ้นมีหลายวิธีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมปรับปรุงพื้นผิว เช่น การ์โบ ในตรายค์ดิ่ง (Carbonitriding) ในตรายด์คิ่ง (Nitriding) เป็นต้น แต่มีวิธีหนึ่งที่เป็นนิยมในอุตสาหกรรมปรับปรุง พื้นผิววัสคุ คือ การเคลือบผิวไอทางกายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) ซึ่งเป็น กระบวนการที่สะอาดและชั้นเคลือบที่ผลิตจากกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพส่วนใหญ่จะ เป็นชั้นเคลือบของสารประกอบเซรามิค เช่น ไทเทเนียมในตรายค์ (TiN) ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-้ในตรายด์ (TiAIN) โครเมียมในตรายด์ (CrN) เป็นต้น ซึ่งเป็นชั้นเคถือบที่มีความแข็งสูง มีความ ทนทานต่อสารเคมี (Chemical resistance) และมีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดี (Thermal stability) ้ช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนให้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติการต้านทานการ ้กัดกร่อนของชั้นเคลือบจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวแปร เช่น วัสดุที่ถูกเคลือบผิว (Substrate) ชนิด ของสารประกอบของชั้นเคลือบ (Chemical composition) ตัวแปรในกระบวนการเคลือบ (Deposition parameters) โครงสร้างของชั้นเคลือบ (Microstructure) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เกลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-้ในตรายด์ งานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนฯ โดยเถือกใช้ตัวกลางการกัด กร่อนที่เป็นคลอไรด์ไอออน เช่น สารละลายโซเคียมคลอไรด์ เป็นต้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ้สารละลายคังกล่าวมีฤทธิ์กัคกร่อนที่ก่อนข้างรุนแรง และมักเป็นสารละลายพื้นฐานที่นิยมใช้ ทคสอบการกัดกร่อนของวัสดุในเบื้องต้น ตามมาตรฐาน ASTM G44 นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจ พฤติกรรมการกัดกร่อนได้ชัดเจนทั้งในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็น กรด กลาง และค่าง จึงต้องปรับ pH ของสารละลายโซเดียมคลอไรค์ให้มีสมบัติดังกล่าว โดยเลือกศึกษาที่ค่า pH 2, 7 และ 10 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ความของชั้นเคลือบมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะ และสมบัติของชั้นเคลือบ ด้วยเหตุ นี้จึงเพิ่มตัวแปรในการศึกษาอีก คือ ความหนาของชั้นเคลือบ ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้กาคว่าจะเป็น ประโยชน์โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเลือกกรรมวิธีปรับปรุง พื้นผิววัสดุให้เหมาะสมในแง่เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

1.2.2 เพื่อศึกษาผลของความหนาชั้นเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ ที่ เคลือบบนผิวของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน

 1.2.3 เพื่อศึกษาผลของก่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบ ที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เกลือบผิวด้วยไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1โลหะที่ถูกเคลือบผิว หรือวัสดุพื้น (Substrate) เพื่อปรับปรุงสมบัติที่ผิว คือ เหล็กกล้าเกรด AISI 4140 โดยมีขนาด คือ กว้าง*ยาว*หนา ประมาณ 18*18*3 มิลลิเมตร

 1.3.2 กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวที่สนใจศึกษา คือ กระบวนการเคลือบผิวด้วยการ เคลือบไอทางกายภาพ โดยชั้นเคลือบผิวที่ต้องการศึกษา คือ ชั้นเคลือบผิวไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN) โดยมีตัวแปรที่ต้องกวบกุมดังนี้

(1) ค่าอัตราส่วนระหว่างแก็สในโตรเจน และอาร์กอนคงที่

(2) ค่าความคัน (Pressure) คงที่

 (3) อุณหภูมิ (สำหรับวัสดุพื้น) ที่ใช้ในการเคลือบไอทางกายภาพคงที่ในที่นี้คือ อุณหภูมิห้อง

(4) เวลาที่ใช้ในการเกลือบ ไอทางกายภาพเปลี่ยนตามความหนาชั้นเกลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม- ในตรายด์ (5) ความหยาบของพื้นผิววัสดุที่ถูกเคลือบ (Roughness of Substrate) กำหนดให้คงที่ โดยมีความหยาบผิวน้อยสุด คือ ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 240, 400, 600, 800, 1000, 1200 และขัดด้วยผงอะลูมิน่า

(6) ความหนาชั้นเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ ทำ3 ระคับ คือ

- ความหนา 250 นาโนเมตร (เคลือบผิวเป็นเวลา 60นาที)
- ความหนา 500 นาโนเมตร(เคลือบผิวเป็นเวลา 120นาที)
- ความหนา 750 นาโนเมตร(เคลือบผิวเป็นเวลา 180นาที)

1.3.3 ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมชิ้นงานตามข้อ 1.3.2 จากนั้นศึกษา ส่วนประกอบ (Constitute) และส่วนผสมทางเกมี (Chemical composition) ของชั้นเกลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่ได้จากกระบวนการเกลือบผิวด้วยการเกลือบไอทางกายภาพ โดย EDX ส่วน โกรงสร้างผลึกศึกษาโดย XRD diffraction นอกจากนี้ศึกษาโกรงสร้างบริเวณพื้นผิวด้วย กล้อง จุลทรรศน์แบบส่องกราดชนิดฟิลอิมิชชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)

1.3.4 ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบ ใทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีในสารละลายตามมาตรฐานสากล คือ ASTM G44: ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก แล้ววัดเส้นโค้ง โพลาไรเซชันของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยการเคลือบไอทางกายภาพเปรียบเทียบกับ เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ยังไม่ผ่านเคลือบผิวแล้วแปลความหมายจากเส้นโพลาไรเซชันที่วัดได้เป็น ความหมายทางการกัดกร่อน กล่าวคือ วิเคราะห์หาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion potential, E_{cor}) ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion current density, I_{cor}) และค่าอัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate, R_{mm})

1.3.5 จากนั้นตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกกัดกร่อน และส่วนผสมทางเคมีของชั้นเคลือบที่ถูก กัดกร่อนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning Electron Microscope, SEM) ร่วม ด้วยการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Chemical composition) ด้วย EDX นอกจากนี้ยังศึกษาองค์ประกอบ และส่วนผสมในแนวชั้นลึกของชั้นเคลือบด้วย การวิเคราะห์สเปกตรัมของการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (X-ray absorption spectroscopy; XAS) และ X-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.4.1 ทราบถึงพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 4140 ที่ เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ 1.4.2ทราบถึงผลความหนาของชั้นเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เกลือบผิวด้วยชั้นเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์

1.4.3 ทราบถึงผลของความเป็นกรด-ค่าง (pH) ของสารละลายที่มีต่อพฤติกรรมการกัด กร่อนของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยชั้นเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์

้ 1.4.4ผลสำเร็จของงานวิจัยนี้ คาดหวังว่าจะเป็นประ โยชน์โดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการปรับปรุงพื้นผิวของโลหะเพื่อใช้งานด้านต้านทานการกัดกร่อน

1.4.5 ในเชิงวิชาการ ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ แนวคิดในการ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระหว่างกระบวนการทำวิจัย โดยผลงานที่ได้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับในแง่ของการผสมผสานความรู้ในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเทคโนโลยีที่นำไปใช้จริงใน ภาคอุตสาหกรรม

 1.4.6 ในเชิงสังคม เป็นการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา อันนำไปสู่ประโยชน์ทางอ้อม คือ ส่งเสริมความมั่งคง ทางด้านวิจัย พัฒนา และเศรษฐกิจของชาติต่อไป



บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กระบวนการเคลือบผิวแข็งด้วยใอทางกายภาพ

กระบวนการเคลือบชั้นผิวแข็งของสารประกอบเซรามิคบนผิวชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการสึกหรอ ความต้านทานต่อการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ ทางวิศวกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท (G. Robert., 1998)คือ

- การเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) ที่มี การสร้าง ผลิตอะตอมของสารเคลือบให้อยู่ในรูปของไอระเหยแล้วไปเคลือบอยู่ บนผิวชิ้นงาน (Substrate) ในระบบที่เป็นสุญญากาศ
- การเคลือบผิวแข็งด้วยไอเคมี (Chemical Vapor Deposition, CVD) เป็น กระบวนการเคลือบผิวชิ้นงานด้วยสารเคลือบที่อยู่ในสถานะก๊าซ โดยที่ก๊าซ เหล่านี้จะทำปฏิกิริยากันจนได้สารผลิตภัณฑ์แล้วเคลือบอยู่บน Substrate

ในงานวิจัยนี้กระบวนหลักที่ใช้เตรียมผิวชิ้นงาน คือ การเกลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ (PVD) ดังนั้นจะกล่าวรายละเอียดอย่างย่อเฉพาะกระบวนเกลือบด้วยไอทางกายภาพเท่านั้น

การเคลือบผิวแข็งด้วยไอทางกายภาพ เป็นกระบวนการที่กระทำในระบบสุญญากาศ และ อะตอมที่จะเคลือบบนผิวชิ้นงานจะมีการเคลื่อนที่โดยปราศจากการชน (Collision) กัน ด้วยเหตุนี้ PVD จึงเป็น Line-of Sight Process ส่วนการเคลือบผิวแข็งด้วยไอเคมี หรือ CVD Process เป็น กระบวนการที่กระทำภายใต้ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure) จึงสามารถควบคุมถักษณะ ชั้นเคลือบ และสามารถเคลือบชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ดีกว่า PVD Process

PVD process สำหรับการเกลือบ Titanium Nitride (Ti_xN) บน Substrate ซึ่งตัว Substrate ก่อนจะเกลือบได้ต้องให้ความร้อนจนมีอุณหภูมิประมาณ 500 องศาเซลเซียสในขณะที่การเกลือบ ใทเทเนียมในตรายค์ด้วย CVD Process จะต้องมีการให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน หรือ Substrate ถึง 1000 องศาเซลเซียสดังนั้นเหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool steels) ที่ผ่านการเกลือบผิวแข็งด้วย PVD process ไม่ จำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีการชุบแข็งด้วยความร้อน ส่วนเหล็กกล้าเครื่องมือที่ผ่านการเคลือบผิวแข็ง ด้วย CVD Process จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มความแข็งให้กับโครงสร้างภายในของชิ้นงานเหล็กกล้า ด้วยกรรมวิธีทางความร้อน อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยพบว่าในเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูป เซ็นเกรค D2 ที่ผ่านการเคลือบผิวแข็ง ใทเทเนียมในตรายค์ด้วย CVD Process (CVD TiN-Coated D2 Tool Steel) เมื่อนำไปให้ความร้อนอีกครั้ง (เป็นการให้ความร้อนจากการเพิ่มความแข็งด้วย กระบวนการทางความร้อน ภายหลังกระบวนการเคลือบผิวแข็ง) ยังคงรักษาชั้นเคลือบที่มีคุณภาพ ปราศจากรอยบกพร่อง และค่าความเค้นเหลือค้างแบบกคบนผิวชั้นเคลือบ (Residual surface compressive stress) ไว้ได้ และมีค่าถึง -1000 MPa

อะตอมของชั้นเคลือบ (Coating atom) สามารถผลิตได้ 3 แบบคือ

- Evaporation
- Sputtering
- Ion plating

ซึ่งทั้งสามแบบจะต้องกระทำในระบบสุญญากาศ กล่าวคือ เมื่อก๊าซที่ต้องการใช้เป็นวัสดุ เกลือบ เช่น ในโตรเจน มีเทน หรือออกซิเจนถูกนำเข้าไปในหลอดสุญญากาศ อะตอมของโลหะก็จะ ทำปฏิกิริยากับอะตอมของก๊าซเพื่อฟอร์มไนตรายด์ การ์ไบด์ หรือออกไซด์

Evaporating กระทำโดยการนำเอาวัสดุดันกำเนิดของชั้นเคลือบ ไปให้ความร้อนในสภาวะที่ เป็นสุญญากาศ (10⁻⁶ kPa or 7.5×10⁻⁶ torr) ทำให้เกิดการระเหยของอะตอม หรือ โมเลกุลภายในท่อ ระบบสุญญากาศแล้วเคลื่อนที่ไปเกาะบนผิวชิ้นงาน (Substrate) อย่างไรก็ตามกรรมวิธีที่ให้ ประสิทธิภาพได้ดีกว่าคือ Sputtering หรือ Ion plating



รูปที่ 2.1 กลไกการทำ Sputtering (G. Robert., 1998Error! Reference source not found.)

Sputtering เป็น PVD Coating Process ที่อะตอมของวัสดุเคลือบถูกขับออกมาโดยอาศัย อะตอมที่มีพลังงานสูงคังแสดงในรูปที่ 2.1 โดยขั้นแรกภายในห้องเคลือบ (Chamber) จะถูกทำให้เป็น สุญญากาศ หลังจากนั้นจะปล่อยก๊าซอาร์กอน (Ar Gas) เข้าไป และวัสดุสำหรับเคลือบ (ในที่นี้ขอ เรียกว่า Target ดูรูปประกอบ) จะถูกทำให้เป็นขั้วลบ (Cathode) โดยการป้อนศักย์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC potential) ระหว่าง -500 ถึง -5000 โวลต์ ก็จะทำให้เกิด Low-Pressure Glow Discharge Plasma ณ บริเวณรอบ ๆ วัสดุสำหรับเคลือบ (Target cathode) แล้วปล่อยประจุบวกของก๊าซอาร์กอน (Ar⁺) ออกมา ซึ่ง Ar⁺จะถ่ายเทโมเมนตัมให้กับวัสดุสำหรับเคลือบ กระตุ้นให้วัสดุสำหรับเคลือบปลดปล่อย อะตอมออกมาแล้วอะตอมนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปเกาะบนผิวชิ้นงาน (Substrate) และบริเวณภายในของ ห้องเคลือบ

Ion platingหมายถึง Plasma-Assisted PVD หรือ Evaporative-Source PVD Process ซึ่ง Plasma ที่เกิดขึ้นนี้จะอาศัยความร้อนในการกระตุ้นให้เกิดการระเหย การพุ่งเข้าชน (Bombardment) ของ Plasma ที่มีพลังงานสูงไปยังผิวชิ้นงาน (Substrate) ทำให้ได้ชั้นเกลือบที่มีความแน่น และการยึด เกาะ (Adhesion) ที่ดีเยี่ยม

2.2 การกัดกร่อน

การกัดกร่อน คือ การสูญเสียเนื้อโลหะโดยการเกิดปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อม อาจเป็นปฏิกิริยา ทางเคมี หรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อนเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งกล่าวคือ สินแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนพื้นโลกเป็นสภาพที่มีเสถียรภาพอยู่แล้ว เมื่อนำสินแร่เหล่านี้มาถลุงให้ได้เนื้อ โลหะบริสุทธิ์ทำให้โลหะอยู่ในสภาวะไม่มีเสถียรภาพมากขึ้น โลหะที่ไม่มีเสถียรภาพจะพยายาม กลับคืนสู่สภาพเดิม คือสินแร่ตามธรรมชาติที่มีเสถียรภาพสูงกว่า ซึ่งก็คือกระบวนการ กัดกร่อน จึงต้องใช้ความพยายามในการที่จะรักษาสภาพของโลหะเหล่านี้ให้เสื่อมสภาพเพราะการกัด กร่อนน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานนาน

2.2.1 การวัดศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และอัตรา การกัดกร่อน

ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion potential, E_{cor}) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อัตรารวมของปฏิกิริยา แอโนดิกทั้งหมดเท่ากับอัตรารวมของปฏิกิริยาแกโทดิก โดยความหนาแน่นกระแสที่ศักย์ไฟฟ้า การกัดกร่อนเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion current density, I_{cor}) ซึ่ง ถือเป็นตัวบ่งชื้อัตราการกัดกร่อนการวัดศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะเกิดการกัดกร่อน (ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์, 2544) สามารถทำได้โดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) ซึ่งมีลักษณะการ วัดดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนโดยเครื่อง โพเทนชิโอสแตท (ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์, 2544)

อิเล็กโทรคที่ใช้มี 3 ชนิคคือ

- อิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode) คือ Ag/AgCl (3M KCl)
- อิเล็กโทรดกระแส (Counter electrode) คือ แพลททินัม (Pt) หรือ แท่งกราไฟต์

(Graphite)

- อิเล็กโทรคตัวอย่าง (Specimen) คือ ชิ้นงานตัวอย่างที่ต้องการทคสอบ

ค่าศักย์ไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิง กับอิเล็กโทรด ตัวอย่าง ค่ากระแสไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบระหว่างอิเล็กโทรดกระแส กับอิเล็กโทรดตัวอย่างจาก ค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ เมื่อนำมาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสอง จะได้กราฟที่เรียกว่า กราฟเส้นโพลาไรเซชัน (Polarization curve)

จากรูปที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของปฏิกิริยาแอโนดิก และปฏิกิริยาแคโทดิกบนพื้นผิวของโลหะที่กำลังเกิดการกัดกร่อน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขั้วไฟฟ้าที่ผิว ความต่างศักย์ของขั้วทั้งสองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังในเส้นกราฟแอโนดิก (Anodic curve) และเส้นกราฟแกโทดิก (Cathodic curve) ตามลำดับ โดยที่ความต่างศักย์ของแอโนดจะเปลี่ยน ก่าไปในทางบวก ส่วนความต่างศักย์ของแกโทดจะเปลี่ยนค่าไปในทางลบ ในลักษณะเช่นนี้แสดงถึง การเกิดโพลาไรเซชันของขั้วทั้งสอง (M. G. Fontana., 1987) สามารถหาค่าศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนได้จากจุดตัดของเส้นความชันของเส้นกราฟแอโนดและ เส้นกราฟแกโทดดังรูปที่ 2.3

เมื่อทราบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนแล้วสามารถหา อัตราการกัดกร่อน (A. J. Sedriks., 1996) ได้จาก

$$R_{mpy} = 0.13 i_{corr} e / \rho$$
 (2.1)

- เมื่อ R_{mpy} = อัตราการเกิดการกัดกร่อน (มิลลิเมตรต่อปี)
 - i_{corr} = ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน (ไมโครแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร)
 - = น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ

е

ρ

= ความหนาแน่นของโลหะ (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)



รูปที่ 2.3 ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน(J. Sedriks., 1996)

2.2.2 เส้นโพลาไรเซชัน (Polarization Curve)

ตัวอย่างการศึกษากล ใกพาสซิวิตี (Passivity) ของเหล็กกล้าไร้สนิม (ประทีป วงศ์บัณฑิต, 2543Error! Reference source not found.) โดยศึกษาจากกราฟเส้นโพลาไรเซชันเมื่อทำการทดลองค่อ จากรูปที่ 2.3 โดยเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไปทางโนเบิล (Noble) จาก E_{cor}และบันทึกก่ากระแสที่ได้ จะได้ดังรูปที่ 2.4

จากกราฟรูปที่ 2.4 ทราบว่าจุดตัดของเส้นกราฟแคโทดิก และเส้นกราฟแอโนดิก คือ ค่า ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อน หรือ E_{cor}เมื่อเพิ่มศักย์ไฟฟ้าต่อถึงจุดหนึ่ง กระแสกลับลดลงเนื่องจากเกิดชั้นฟิล์ม พาสสีฟบนผิวโลหะ เรียกค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดว่าเป็นจุดการเปลี่ยนแปลงแอคทีฟ-พาสสีฟ (Active-passive transition) และค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าพาสซิเวชันปฐม (Primarily passive potentials) ใช้สัญลักษณ์ E_{pp} เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าต่อไปกระแสจะเริ่มลดลงจนคงที่ที่ค่าหนึ่งแม้ จะเพิ่มศักย์ไฟฟ้าให้แก่เซลล์ต่อไปความหนาแน่นของกระแสก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงกราฟที่ กระแสคงที่นี้เรียกว่าช่วงพาสสีฟ (Passive zone) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความทนทาน ของฟิล์มบนผิวโลหะ ถ้ายังเพิ่มศักย์ไฟฟ้าต่อไปอีกจนถึงค่าหนึ่งที่ชั้นฟิล์มพาสสีฟแตกทำให้กระแส เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกช่วงที่เลยจุดนี้ว่า ช่วงทรานพาสสีฟ (Tranpassive zone) และเรียกศักย์ไฟฟ้า ที่จุดนี้ว่าศักย์ไฟฟ้าทรานพาสสีฟ ใช้สัญลักษณ์ E_iศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เป็นค่าที่โลหะเริ่มกัดกร่อน เฉพาะที่ คือ การกัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (Pitting corrosion) ซึ่งหากป้อนศักย์ไฟฟ้าเกินค่า E_i จะ เกิดการแตกของชั้นฟิล์มพาสสีฟจุดใหม่เพิ่มขึ้น และชั้นฟิล์มจุดที่แตกเดิมจะมีการขยายตัวของรูเข็ม หรือหลุมใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเส้นโพลาไรเซชันที่ได้จากการทดลองของโลหะตัวอย่างใน สารละลายที่ไม่มีคลอไรค์และสารละลายที่มีคลอไรค์พบว่าในสารละลายที่มีคลอไรด์จะให้ค่า E_iหรือ อีกนัยหนึ่งเรียกว่า ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (Pitting potential) ใช้สัญลักษณ์ E_iต่ำกว่า และมีความกว้างช่วงพาสสีฟแคบกว่าเส้นโพลาไรเซชันที่ได้จากการทดลองในสารละลายที่ไม่มีคลอ ไรด์



รูปที่ 2.4 ส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโพลาไรเซชัน (ประทีป วงศ์บัณฑิต., 2543Error! Reference source not found.)

ตัวแปรที่มีผลต่อเส้นโพลาไรเซชันได้แก่ ปริมาณออกซิเจนในสารละลายอัตราการแสกน อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองความเข้มข้นของสารละลาย และอัตราการกวน กล่าวโดยทางอ้อมตัวแปร ต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานตัวอย่าง

2.3 การวิเคราะห์ชั้นเคลือบ

สำหรับการวิเคราะห์ชั้นเคลือบในการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM) และ Scanning Electron Microscope (SEM) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.3.1 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 1182 X-ray photoemission electron microscopy (X-PEEM)

XPS และ X-PEEM ที่ใช้แสงซินโครตรอนจะอยู่ในช่วงพลังงาน 50 -1000 eV จากระบบ ลำเลียงแสง BL3 ของห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยแสงในช่วงพลังงานดังกล่าวมีประโยชน์ใน การศึกษาสภาวะทางเคมีที่ผิวหน้าสารทำให้สามารถระบุปฏิกิริยาตัวกลาง (Intermediate reaction) ที่ เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวและรอยต่อระหว่างพื้นผิวสารหรือการสึกหรือได้ การตรวจสอบดังกล่าว สามารถทำได้ เนื่องจากมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแยกแยะสเปกตรัม (Spectral resolution) และความไวในการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุจากการใช้แสงซินโครตรอนที่สามารถปรับเปลี่ยนก่าพลังงาน ได้ดังรปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 แสดงชั้นระดับพลังงานของ XPS (A. Einstein., 1905)

นอกเหนือข้อมูลเชิงเคมีที่ได้ เทคนิค X-PEEM ยังสามารถทำการถ่ายภาพบริเวณที่ทำการวัด และยังสามารถเลือกบริเวณที่จะศึกษาโดยมีความสามารถในการแยกแยะในระดับ100 นาโนเมตร

2.3.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เป็นเทคนิคที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบ คุณสมบัติของพื้นผิวของวัสดุ เนื่องจาก SEM มีกำลังขยายตั้งแต่ 20 – 30,000 เท่า และใช้คุณสมบัติ กลื่นของอิเล็กตรอน สามารถวิเคราะห์ชั้นเคลือบในแนวลึกได้กว่า 300 เท่าของกล้องจุลทรรศน์ปกติ กำให้เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์ผิวในรายละเอียด ชิ้นทดสอบสำหรับการวิเคราะห์ด้วย SEM จะมี ขนาดเล็ก เช่น บางกว่า 20 มิลิเมตร (≤0.8 นิ้ว) และความสูงไม่เกิน 80 มิลลิเมตร (≤3.5 นิ้ว) และต้อง ทำความสะอาดด้วยสารละลายอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากชิ้นทดสอบต้องอยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ความ ดันต่ำกว่า 1.3 มิลลิพาสกาล (mPa) (10⁻⁵ บาร์) และหากชิ้นทดสอบไม่นำไฟฟ้าก็จะต้องเคลือบด้วย การ์บอนหรือทองกำเพื่อให้อิเล็กตรอนไปสะสมตัวบนผิวชิ้นงานได้

2.4 การทบทวนวรรณกรรม (Reviewed literature) /สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง

จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ (L. Cunha and et al., 1999; S. H. Ahn and et al., 2002; J. Y. Chen and et al., 2000; E. Lunarska and et al., 1996; C. Liu and et al., 1995 and H. A. Jehn., 2000) พบว่าเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีธาตุผสมต่ำถึงปานกลาง หรือเหล็กกล้าเครื่องมือต่างๆ เมื่อ ผ่านการคเลือบผิวด้วยวิธีเคลือบด้วยไอกายภาพ คุณสมบัติการต้านการกัดกร่อนดีขึ้น โดยคุณสมบัติ การต้านทานการกัดกร่อนของชั้นเคลือบผิวจะเปลี่ยนแปลงตามวัสดุที่ถูกเคลือบผิว ชนิดของ สารประกอบและลักษณะ โครงสร้างของชั้นเคลือบ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัด กร่อนของชั้นเคลือบ กรต้าง เลือบผิวยังขึ้นเกลือบ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัด กร่อนที่มี รายุคนสมบัติ กร่อนของชั้นเคลือบ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัด กร่อนของ ถึง เกลือบ นอกจากนี้ยังหมาย์ กล้อบ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัด กร่อนของ ถึง เกลือบ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติการต้านทานการกัด กร่อนของ ถึง เกล้างาวะแวดล้อมการใช้งานอีกด้วย

(L. Cunha and et al., 1999) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบโครเมียมใน ตรายค์และไทเทเนียมอะลูมิเนียมในตรายค์ที่ผลิตจากกระบวนการเคลือบผิวแบบไอทางกายภาพ โดย ศึกษากลไกการเกิดการกัดกร่อนของชั้นเคลือบในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากผลการทดลอง ด้วยเทคนิก X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) พบว่าการกัดกร่อนเกิดขึ้นจากการแพร่ของ สารละลายผ่านข้อบกพร่อง (Defect) ของชั้นเคลือบในรูปแบบการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (Pitting corrosion) ทำให้เกิดการสูญเสียในโตรเจนในชั้นเคลือบและส่งผลให้ออกซิเจนสารมารถแพร่เข้าไป ชั้นเกลือบและเกิดการออกซิเดชั่นกลายเป็นผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนหรือออกไซด์ของเหล็กได้ นอกจากนี้มีการทดสอบการกัดกร่อนเปรียบเทียบระหว่างชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบโครเมียมในตรายด์ และที่ผ่านการเคลือบไทเทเนียมอะลูมเนียมในตรายด์ด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat) จาก การทดสอบพบว่าชั้นเคลือบโครเมียมในตรายด์มีความสามารถในการด้านทานการกัดกร่อนใน สารละลายที่มีองค์ประกอบของคลอไรด์ได้ดีกว่าชั้นเคลือบไทเทเนียมอะลูมิเนียมในตรายค์ และยังมี ข้อสรุปที่ว่าชั้นเคลือบที่มีปริมาณรูพรุนหรือความหนาแน่นของรูพรุนน้อยจะช่วยให้ชั้นเคลือบมี ความสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า

(S. H. Ahn and et al., 2002) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบโครเมียมใน ตรายค์ที่มีเฟส (phases) แตกต่างกัน ได้แก่ CrN และ Cr₂N ที่เคลือบบนผิวของเหล็กกล้าเครื่องมือ เกรค H13 โดยการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical method) เปรียบเทียบ ้กับเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด H13 ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้น ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก จากการศึกษาพบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด H13 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ้โครเมียมในตรายด์ทั้งสองเฟสจะมีค่าความหนาแน่นกระไฟฟ้าการกัดกร่อนที่น้อยกว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด H13 ที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว และพบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ เกรด H13 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยโครเมียมในตรายค์ในรูปแบบเฟสของ CrN จะมีค่าความ หนาแน่นกระไฟฟ้าการกัดกร่อนน้อยกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด H13 ที่ผ่านการเคลือบโครเมียมไน ตรายค์ในรูปแบบเฟส Cr,N เนื่องจากชั้นเคลือบ โครเมียมในตรายค์ในรูปแบบเฟสของ CrN นั้นมี ้โกรงสร้างที่มีความหนาแน่นและสม่ำเสมอ มีปริมาณรพรนที่น้อยกว่า โดยสันนิฐานจากผลของการ ้ วัดค่าความเป็นรูพรุน(porosity) จากกราฟโพลาไรเซชัน จะแสดงให้เห็นว่าชั้นเคลือบโครเมียมไน ตรายค์ในรูปแบบเฟสของ CrN นั้นมีค่าความเป็นรูพรูน(Porosity) ประมาณ 0.0015 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง ้น้อยกว่าชั้นเคลือบโครเมียมในตรายค์ในรูปแบบเฟสของ Cr.N ที่มีค่าความเป็นรูพรุน(Porosity) ประมาณ 0.0041 เปอร์เซ็นต์ และสอคคล้องกับผลของ โครงสร้างชั้นเคลือบที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราค(Scanning electron microscopy, SEM)ที่แสดงให้เห็นว่าชั้นเคลือบ โครเมียมในตรายค์ในรูปแบบเฟสของ CrN มีปริมาณรูพรุนที่น้อยกว่า

(J. Y. Chen and et al., 2000) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนและการยึดเกาะของไทเทเนียม ในตรายค์ฟิล์มที่ผลิตจากกระบวนการเกลือบผิวแบบไอทางกายภาพโดยการเกลือบไทเทเนียมใน ตรายค์ฟิล์มบนพื้นผิวของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรค AISI 304 ทำการทคสอบการกัดกร่อนในสาระลาย 1 N H₂SO₄+0.05 M KSCN โดยวิธี Potentiodynamic polarization และวัดการยึดเกาะของชั้นฟิล์มด้วย วิธี periodic cracking จากผลการศึกษาพบว่าภายหลังการเกลือบผิวเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยไทเทเนียม ในตรายค์ฟิล์ม จะทำให้มีการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กกล้าไร้สนิมที่ยัง ใม่ผ่านการเกลือบผิว นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของไทเทเนียมใน ตรายค์ฟิล์มจะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของชั้นฟิล์มและการยึดเกาะของชั้นฟิล์ม โดยกล่าวไว้ว่า โครงสร้างของชั้นฟิล์มที่มีปริมาณข้อบกพร่อง(Defect) มากและการยึดเกาะระหว่างชั้นเกลือบและ ชิ้นงานที่ไม่ดีจะส่งผลให้ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนลดน้อยลง (E. Lunarska and et al., 1996) ได้ศึกษาผลของชั้นเคลือบไทเทเนียมในตรายด์และอุณหภูมิ ในการเคลือบผิว (Deposition temperature) ด้วยกระบวนการเคลือบไอทางเคมี โดยทำการเคลือบด้วย ไทเทเนียมในตรายด์ฟิล์มบนเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงในช่วงอุณหภูมิ 570 – 720 องศาเซลเซียส แล้วนำไปทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่แตกต่างกันได้แก่ สารละลายกรดซัลฟูริก (H₂SO₄) สารละลายกรดฟอสฟอริก (H₃PO₄) และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จากการศึกษา พบว่าชั้นเคลือบไทเทเนียมในตรายด์สามารถปรับปรุงการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า เครื่องมือความเร็วสูงให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า เกรื่องมือความเร็วสูงให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อนของ ใทเทเนียมในตรายด์ฟิล์มนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นเคลือบซึ่งจะมีผลมาจากตัวแปรใน กระบวนการเคลือบคือ อุณหภูมิในการเคลือบผิว จากการศึกษาผลของอุณหภูมิในการเคลือบผิว ในช่วง 570 – 720 องศาเซลเซียส จะพบว่าการเกลือบผิวด้วยไทไทเนียมในตรายด์ที่อุณหภูมิ ประมาณ 670 องศาเซลเซียส เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเคลือบผิว เนื่องจากจะทำให้ได้ชั้น

(C. Liu and et al., 1995) ได้ศึกษาผลของความหยาบผิวของเหล็กกล้าก่อนการเคลือบผิวค้วย โครเมียมในตรายด์ที่ผลิตด้วยกระบวนการไอกายภาพต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน ก่อนการเคลือบผิว ได้ทำการเตรียมผิวเหล็กกล้าให้มีความหยาบแตกต่างกัน หลังจากนั้นทำการทดสอบการกัดกร่อนใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนักด้วยการวัดความต้านทานเชิงซ้อน (Impedance) จากการศึกษาพบว่าเมื่อความหยาบผิวละเอียดมากขึ้นจะส่งผลให้การต้านทานการกัด กร่อนดีขึ้น โดยมีข้อสันนิฐานว่าขึ้นงานที่มีความหยาบผิวละเอียดขึ้นอาจส่งผลให้กัต้อนการกัด ปริมาณข้อบกพร่องที่น้อยลงส่งผลให้ได้ชั้นเคลือบที่เรียบและมีการยึดเกาะที่ดีกว่ากับวัสดุทำให้ได้ ชั้นเคลือบที่มีความหนาแน่นและสม่ำเสมอ สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดีขึ้น

(H. A. Jehn., 2000) ได้ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ความหนาของชั้นเคลือบ ตัวแปร ของกระบวนการเคลือบ และความหยาบผิวของชิ้นงานก่อนการเคลือบ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวจะมีผลต่อ คุณสมบัติทางด้านการกัดกร่อนของชั้นเคลือบที่ผลิตจากกระบวนการเคลือบผิวไอทางกายภาพ จาก การศึกษาพบว่าการเพิ่มความหนาของชั้นเคลือบจะช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติการด้านทานการกัด กร่อนให้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชั้นเคลือบ และจากการศึกษาผลของกระบวนการเคลือบ และตัวแปรต่างๆ ในกระบวนการเคลือบนั้นจะพบว่าตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อลักษณะ โครงสร้างของชั้น เกลือบ กระบวนการเกลือบไอทางกายแบบ ion plating จะผลิตชั้นเคลือบที่มีโครงสร้างที่หนาแน่น มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเคลือบไอทางกายภาพแบบ Evaporation และความหยาบผิว ของชิ้นงานก่อนการเคลือบที่ละเอียดกว่าจะส่งผลทำให้มีการต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่า เนื่องจาก ความหยาบผิวชิ้นงานที่ละเอียดกว่าจะทำให้ชั้นเคลือบมีความสามารถในการยึดเกาะกับชิ้นงานที่ ดีกว่า

(S. Korablov and et al., 2005) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบ TiN, TiAlN และCrN ที่เคลือบบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 ในสารละลาย Na,HPO,ที่อณหภมิต่างๆ คือ ที่ 600, 700 และ 850 องศาเซลเซียส พบว่าฟิล์มทุกชนิคมีเสถียรภาพดีที่สารละลายในสภาพที่เป็นกลาง และถูกทำลายที่ภาวะความเป็นกรดของสารละลาย

(V. Chawa and et al., 2009) ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของ TiAlN และ AlCrN ที่ เคลือบบนผิวเหล็ก Incolov 800H โดยใช้การทดสอบแบบพ่นละอองน้ำเกลือ (Salt sprav test) พบว่า ้ชิ้นงานที่ไม่ได้เกลือบผิว และชิ้นงานที่เกลือบผิวด้วย TiAIN และ AlCrN มีความต้านทานการกัด กร่อนดี แทบไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ V. Chawla และจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนเพิ่มเติม ้ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าของชิ้นงานดังกล่าวในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่อุณหภูมิห้อง พบว่าชั้นเคลือบทั้งสองให้ค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ต่ำ กว่าชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบ

้จากผลที่รายงานในวรรณกรรมคังกล่าวข้างต้น พบว่าพถติกรรมการกัคกร่อนของเหล็กชนิค ต่างๆ ที่ผ่านการเกลือบผิวด้วยไอระเหยทางกายภาพ (Physical Vapor Deposition, PVD) ด้วยชั้น เคลือบ TiN, CrN, TiAIN และ AlCrN มีแนวโน้มต้านทานการกัคกร่อนมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีตัว แปรเช่น ความหนาของชั้นเคลือบ และ สภาพความเป็นกรด กลาง ค่างของสิ่งแวคล้อมการกัคกร่อนที่ ควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้ได้ชั้นเคลือบที่ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตนึ้งานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าการ์บอน AISI 4140ที่ผ่านการเคลือบด้วย ไทเทเนียม-้อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ สภาพการเตรียมผิวและสภาพความเป็นกรด-ด่างของสารละลายเปลี่ยนไป ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานต่อ การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต ^{ุทย}าลัยเทคโนโลยีสุร[ู]ง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

3.1.1 วัสดุพื้นที่ใช้ในการวิจัย

โลหะที่ถูกเคลือบหรือวัสดุพื้น (Substrate) เพื่อปรับปรุงกุณสมบัติที่ผิว คือ เหล็กกล้ำ AISI 4140ก่อนทำการทดลองนำชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ไปทำการตรวจสอบ ส่วนผสมทางเคมีโดยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้า AISI 4140 แสดงใน ตารางที่ 3.1

,			9/	
a 1	a . I	। ব র বিশ	ο e.	ର ହ
ตารางที่ 3 1 สว	บมผสมทางเคม (เป	ໄຄຽເຫນງຫ ໄທຍ	ເບົາหນก) ຈເຊ	องเหลกกล้า AISI 4140

ື້ອ	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (%Wt)						
ชนงเน	С	Si	Mn	Cr	Мо	V	Fe
AISI 4140	0.431	0.240	0.825	1.030	0.199	0.005	Balance

3.1.2 สารเคมีที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

3.1.2.1 สารเกมีสำหรับเตรียมผิวชิ้นงานแสดงในรูปที่ 3.1

 กรดในตริก เป็นกรดสำหรับกัดผิวชิ้นงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้าง จุลภาคก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน

- เอทานอล และน้ำกลั่นใช้สำหรับทำความสะอาคชิ้นงานก่อนและหลังการ

เคลือบผิว

- ซิลิกาเจล ใช้ดูดความชื้นสำหรับเก็บชิ้นงาน
- ผงอะลูมิน่า ใช้ในขั้นตอนการขัคละเอียดผิวชิ้นงาน
- 3.2.1.2 สารเคมีสำหรับกระบวนการเคลือบ
 - แก๊สอาร์กอน
 - แก๊สในโตรเจน

3.2.1.3 สารเคมีสำหรับการทดสอบการกัดกร่อน

- โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
- กรดไฮโครคลอริก(HCl)
- โซเคียมไฮครอกไซค์ (NaOH)



รูปที่ 3.1 สารเคมีสำหรับเตรียมผิวชิ้นงาน

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้งานใน แต่ละขั้นตอนการทดลอง ดังนี้

3.2.1 อุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่างก่อนการเคลือบผิว

3.2.1.1 เครื่องตัดชิ้นงาน EDM WIRECUT รุ่น CHARMILLS TECHNOLOGIES
3.2.1.2 ROBOFIL-190 พร้อมด้วยลวดตัดทำด้วยโลหะทองเหลืองขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร

 3.2.1.3 เตาอบขึ้นงาน รุ่น CARBOLITE (SCIENTIFIC PROMOTCO., LTD.) สำหรับกระบวนการอบชุบทางความร้อนให้กับขึ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 เตาอบชิ้นงาน



รูปที่ 3.3 เครื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานหมุนยี่ห้อ BUEHLER

3.2.1.4 เครื่องขัดผิวชิ้นงานแบบจานหมุนยี่ห้อ METKON FORCIPOL 2V GRINDER POLISHER เป็นอุปกรณ์ในการขัดหยาบและขัดละเอียดผิวชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการ เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 3.2.1.5 กระคาษทรายเบอร์ 180, 320, 400, 600, 800, 1000,1200 และผ้า สักหลาด ใช้ในการขัดหยาบและขัดละเอียดผิวชิ้นงานดังแสดงในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 กระคาษทรายที่ใช้ในการขัดผิวชิ้นงาน



รูปที่ 3.5 เกรื่องวัดความแข็ง Rockwell Hardness Tester 660

3.2.1.6 เครื่องวัดความแข็ง Rockwell Hardness Tester 660 เป็นอุปกรณ์ใน การตรวจสอบความแข็งของชิ้นงานก่อน และหลังกระบวนการอบชุบทางความร้อน ก่อนเข้าสู่ กระบวนการเกลือบผิวค้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ คังแสคงในรูปที่ 3.5

3.2.2 อุปกรณ์สำหรับกระบวนการเคลือบผิว

3.2.2.1 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบดีซีอันบาลานซ์แมกนิตรอนสปัตเตอริง ลักษณะและ ใดอะแกรมของเครื่องเคลือบแสดง ในรูปที่ 3.6 ห้องเคลือบทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 31.0 เซนติเมตร สูง 31.0 เซนติเมตร มีเป้าสารเคลือบเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ไทเทเนียม (99.97%) และ อลูมิเนียม (99.97%) พร้อมภาคง่ายไฟฟ้าแรงสูง กระแสตรง ใช้แก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สสปัตเตอร์ และแก๊ส ในโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊ส ไวปฏิกิริยา ซึ่งลักษณะการวางชิ้นงานภายในห้องเคลือบแสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.6 ลักษณะและไคอะแกรมของเครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัย



รูปที่ 3.7 ลักษณะคาโทค การวางชิ้นงาน และพลาสมาขณะเคลือบ

3.2.2.2 เครื่องควบคุมอัตราใหลมวลแก๊สด้วย mass flow controller ของ MKS รุ่น type247D ใช้ในการควบคุมการง่ายแก๊สในการเคลือบ

3.2.2.3 เครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ไอมีเครื่องสูบกล โรตารีเป็นเครื่องสูบท้าย ใช้มาตรวัดกวามดันของ PFEIFFER ซึ่งใช้ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และ มาตรวัดกวามดันชนิด Compact Full Range Gauge รุ่น PKR251



รูปที่ 3.8 เครื่องโพเทนชิโอสแตท

3.2.3 อุปกรณ์สำหรับทดสอบการกัดกร่อน

3.2.3.1 เครื่องโพเทนชิโอสแตท autolab รุ่น PGSTAT302N คังแสคงในรูปที่ 3.8 เป็นเครื่องใช้ทคสอบการกัคกร่อน



รูปที่ 3.9 อิเล็ก โทรคที่ใช้ในการทคสอบการกัดกร่อน

3.2.3.2 อิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนดังแสดงในรูปที่ 3.9

 หมายเลข 1 อิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode) คือ Ag / AgCl (3 M
 KCl) (Silver/Silver chloride electrode) เป็นขั้วอ้างอิงเมื่อวัดเทียบกับ อิเล็กโทรดตัวอย่าง (Working electrode) จะได้ศักย์ไฟฟ้าของตัวอย่างนั้น

-หมายเลข 2 อิเล็กโทรควัดกระแส (Counter electrode) คือแท่งกราไฟต์ (Graphite) เป็นขั้วอ้างอิงเมื่อวัดเทียบกับ อิเล็กโทรคตัวอย่าง (Working electrode) จะได้

กระแสไฟฟ้าของตัวอย่างนั้น

- หมายเลข 3 อิเล็กโทรคตัวอย่าง (Working electrode) คือ ชิ้นงานของ เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ยังไม่ผ่านการเกลือบผิวและผ่านการเกลือบผิวด้วย TiAIN

3.2.3.3 เครื่องวัดค่าพีเอชของสารลาย

3.2.3.4 เครื่องแก้วสำหรับเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนักที่มีพีเอชเท่ากับ 2, 7 และ 10 ซึ่งประกอบด้วย กระบอกตวง บีกเกอร์ แท่งแก้วกวนสารละลาย งวคเก็บสารละลาย และหลอดหยด

3.2.4 อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบพื้นผิว

3.2.4.1 กล้องจุลทรรศน์ รุ่น BX51 Olympus High Power Microscope เป็น อุปกรณ์ในการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อน และหลัง กระบวนการอบชุบทางความร้อน ก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ใน ตรายค์ ดังแสดงในรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10กล้องจุลทรรศน์ รุ่น BX51 Olympus High Power Microscope

3.2.4.2 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิคฟิลอิมิชชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) ของ JEOL รุ่น JSM-7800F นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับ การศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับจุลภาค เนื่องจากเป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มีกำลังขยาย สูงถึง 1,000,000 เท่า ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้างระดับนาโนเมตรได้ และยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer ; EDS) ซึ่งช่วยในการศึกษา ชนิด ปริมาณ และการกระจายขององค์ประกอบธาตุของวัสดุที่ศึกษาได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.11

3.2.4.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Photoemission electron microscopy (PEEM) เป็นการรวมเทคนิคการดูภาพเหมือนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กับ เทคนิคทางด้าน Spectroscopy ด้วยการใช้แสงซินโครตรอน ดังแสดงในรูปที่ 3.12ซึ่งการใช้เทคนิคนี้ ทำให้สามารถเลือกและเปลี่ยน ก่าพลังงานแสงที่ใช้กระตุ้นอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากผิวของสารตัวอย่างจึงสามารถวิเคราะห์ธาตุ
และองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุบนสารตัวอย่าง จึงสามารถวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี ของวัตถุบนสารตัวอย่างด้วยเทคนิค Micro X-ray absorption spectroscopy (µ-XAS)



รูปที่ 3.11 กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิคฟิลอิมิชชั่น (FE-SEM)



รูปที่ 3.12 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Photoemission electron microscopy

3.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ในงานวิจัยนี้มีหลายขั้นตอน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ เริ่มต้นด้วยการเตรียมผิวของเหล็กกล้า AISI 4140ก่อนเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ การเคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ การทดสอบการกัดกร่อน และขั้นตอนสุดท้าย การตรวจสอบผิวตัวอย่างหลังการทดสอบการกัดกร่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพการคำเนินการวิจัย ดัง แสดงในรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 แผนภาพระเบียบวิธีการทำวิจัย



รูปที่ 3. 14 ชิ้นงานในงานวิจัย

3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานก่อนเคลือบผิว

3.3.1.1 ตัดชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ให้ได้ขนาด 18x18x3 มิลลิเมตร ดังแสดง ในรูปที่ 3.14 หลังจากนั้นนำชิ้นงานอบชุบทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแก่ชิ้นงานเหล็กกล้า โดย ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นทำให้ชิ้นงานเย็น ตัวอย่างรวดเร็วในน้ำมัน จากนั้นนำชิ้นงานก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน วัดความแข็งและ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ค่าความแข็งที่ได้แสดงในตารางที่ 3.2

	9			
ชิ้นงาน	f	่าความ	แเข็ง(H	RC)
	1	2	3	เฉลี่ย
เหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการอบชุบทางความร้อน	32.0	28.5	31.6	30.7
เหล็กกล้ำ AISI 4140 หลังการอบชุบทางความร้อน	55.4	54.6	53.9	54.6

ตารางที่ 3.2 ค่าความแข็งของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน

3.3.1.2 ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค นำชิ้นงานมาขัดหยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 320, 400, 600, 800, 1000 และ 1200 ตามลำดับหลังจากนั้นทำการขัดละเอียดด้วยผงอะลูมิน่า ทำ การกัดผิวหน้าชิ้นงานด้วยกรด Nital 2% แล้วทำการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ แบบแสงโดยโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนและหลังอบชุบทางความร้อนได้แสดง ในรูปที่ 3.15 พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนอบชุบทางความร้อนโครงสร้างจุลภาค ประกอบด้วยเฟอร์ไรท์ (Ferrite)และเพิร์ลไลท์ (Pearlite) และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 หลังอบชุบ ทางความร้อน โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยมาร์เทนไซต์ (Martensite) และออสเตนในท์เหลือค้าง (Retained austenite)



ก) โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อนการอบชุบทางความร้อน



โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้ำ AISI 4140 หลังการอบชุบทางความร้อน

รูปที่ 3.15 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน

3.3.1.3 เตรียมผิวชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการอบชุบทางความร้อนก่อน
เข้าสู่กระบวนการเคลือบผิว โดยขัดผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200
ผงอะลูมินาขนาด 1 ไมครอนและผงอะลูมินาขนาด 0.5 ไมครอนตามลำดับ

3.3.2 ขั้นตอนกระบวนการเคลือบผิวใอทางกายภาพ

กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ (TiAIN) ด้วยวิธีรี แอกทีฟดีซีโคแมกนีตรอนสปัตเตอริง มีตัวแปรในกระบวนการเคลือบคังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ตัวแปรในการเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN)ด้วยวิธี รีแอกทีฟดีซีโคแมกนีตรอนสปัตเตอริง

ตัวแปร	ค่ากำหนด
เป้าสารเคลือบ (Target)	ไทเทเนียม (Ti), อะลูลิเนียม (Al)
ความคันฐาน (มิลลิบาร์)	5.0×10^{-5}
ความดันขณะเคลื่อบ (มิลลิบาร์)	5.0×10^{-3}
อัตราไหลแก๊สอาร์กอน (sccm)	16
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน (sccm)	8
กระแสไฟฟ้าไทเทเนียม (มิลลิแอมป์)	900
กระแสไฟฟ้าอะลูมิเนียม (มิลลิแอมป์)	300
ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบถึงวัสคุรองรับ (เซนติเมตร)	18
เวลาในการเคลือบ (นาที)	60, 120, 180
อุณหภูมิขณะเคลือบผิว	อุณหภูมิห้อง

นำเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ผ่านการเตรียมผิวเคลือบผิวด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคแมกนีตรอน สปัตเตอริงเพื่อให้ได้สารเคลือบที่เป็น ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ โดยในขั้นตอนนี้ได้แบ่งตัว อย่างออกเป็นสามกลุ่ม ตามเวลาในการเคลือบ คือกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ เป็นเวลา 60 นาทีกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ใน ตรายด์ เป็นเวลา 120 นาที และ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ เป็น เวลา 180 นาที ทำให้ได้ความหนาของชั้น TiAIN คือ 250, 500 และ 750 นาโนเมตร ตามลำดับ โดย มีรายละเอียดของขั้นตอนการเคลือบดังนี้

3.3.2.1 นำเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการเตรียมผิวเข้าห้องเคลือบวางชิ้นงานห่าง จากเป้าสารเคลือบเท่ากับ 18 เซนติเมตร

3.3.2.2 ถุดความดันในห้องเคลือบให้ได้ความดันพื้นเท่ากับ 5.0x10⁻⁵มิลลิบาร์
3.3.2.3 ปล่อยแก๊สอาร์กอนและแก๊สในโตรเจนเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศตามค่าที่
กำหนดในตารางที่ 3.3 โดยกำหนดให้อัตราไหลแก๊สอาร์กอนเท่ากับ 16 sccm และแก๊สไนโตรเจน
เท่ากับ 8sccm กำหนดกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เป้าอลูมิเนียม (I_{Al}) และกระแสไฟฟ้าในการ

สปัตเตอร์เป้าไทเทเนียม (I_n) คงที่เท่ากับ 300 มิลลิแอมป์ และ 900 มิลลิแอมป์ ตามลำคับ ฟิล์มแต่ละ ชุดเกลือบนานเป็นเวลา 60120 และ 180 นาที

3.3.2.4 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเคลือบฟิล์ม ปิดแหล่งจ่ายไฟ ปิดแก๊ส
อาร์กอนปิดแก๊สไนโตรเจน และปล่อยอากาศเข้าไปในภาชนะสุญญากาศเพื่อนำตัวอย่างออก
3.3.2.5 นำตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบผิววัดความหนาของชั้นเคลือบโดยอาศัยเทียบ

แถบวัด (Scale bar) ของภาพถ่าย 2 มิติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก) กำหนดความยาวของแถบวัด (Scale bar) กับความละเอียดของ ภาพถ่าย (Pixels) จะได้ความละเอียดของภาพต่อขนาดของภาพดังแสดงในรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 ขั้นตอนการวัคความหนาของชั้นเกลือบโดยอาศัยเทียบแถบวัค (Scale bar)

 บ) วัดขนาดกวามหนาของชั้นเกลือบ โดยวัด 3 จุด แล้วหาก่าเฉลี่ยของ กวามหนาชั้นเกลือบ ผลของก่ากวามหนาของชั้นเกลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ แสดงใน ตารางที่ 3.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาในการเกลือบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กวามหนาของชั้นเกลือบเพิ่มขึ้น

		ଧ		
เวลาในการเคลือบ	ความหน	าของ ชั้นเคลือบไทเ	ทเนียม-อะลูมิเนียม-ไ	ในตรายค์
(นาที)		(นาโน	แทพร)	
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ค่าเฉลี่ย
60	248	249	252	249.6
120	503	500	502	501.6
180	767	744	765	758.6

ตารางที่ 3.4 ก่ากวามหนาของเกลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวก่อนทดสอบการกัดกร่อน

3.3.3.1 นำเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ไปวัดส่วนประกอบ (Constitute) และส่วนผสมทางเคมี (Chemical composition) ด้วย เทกนิก X-ray diffraction (XRD)

3.3.3.2 นำเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ตรวจสอบพื้นผิว (Surface) และ โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่อง กราด (Scanning electron microscope, SEM) ร่วมด้วยการตรวจส่วนผสมทางเคมีด้วยเทคนิค EDS

3.3.4 ขั้นตอนการทดสอบการกัดกร่อน

3.3.4.1 นำตัวอย่างที่ไม่เคลือบผิว และตัวอย่างที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ไปทดสอบการกัดกร่อนด้วยเครื่องโพเทนซิโอสแตท (Potentiostat) ใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีก่าพีเอช (pH) เท่ากับ 2, 7 และ 10 โดยควบกุม สภาวะการทดลองให้คงที่ คือ

- อัตราการแสกนเท่ากับ 0.01 โวลต์ต่อวินาที

- อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลองเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส

- ความเข้มข้นของโซเคียมคลอไรค์เท่ากับ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก การ

เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ทำโคยนำโซเดียมคลอไรค์ 3.5 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 96.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน 3.3.4.2 ทำการปรับค่าพีเอช (pH) ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์เท่ากับ 3.5
เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้มีค่าเท่ากับ 2, 7 และ 10 โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCI) ความเข้มข้น 1
โมลาร์ และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 1 โมลาร์ ในการปรับค่าพีเอช (pH)



รูปที่ 3.17 การติดตั้งชุดเซลล์การกัดกร่อน

3.3.4.3 หลังจากนั้นทำการติดตั้งเซลล์การกัดกร่อน ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ใส่ สารละลายโดยให้ชิ้นงานสัมผัสกับสารละลายเป็นพื้นที่ 1.134 ตารางเซนติเมตร ชิ้นงานทดสอบจะ เป็นอิเล็กโทรดตัวอย่าง (หมายเลข 1) ต่อเข้ากับอิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode) ที่เป็น Ag/AgCl (หมายเลข 2) และใช้แท่งกราไฟต์เป็นอิเล็กโทรดกระแส (หมายเลข 3)จุ่มลงในสารละลาย ต่อขั้วอิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode)และอิเล็กโทรดกระแส (Counter electrode) เข้ากับ เครื่องโพเทนชิโอสเตท

3.3.4.4 วัดค่า Open Circuit Potential (OCP) ของตัวอย่าง

3.3.4.5 เมื่อสิ้นสุดการวัด Open Circuit Potential (OCP) ทำการป้อนศักย์ไฟฟ้า ทดสอบ -900 ถึง +200 มิลลิโวลต์

3.3.4.6 แปลความหมายของเส้นกราฟที่ได้จากการทดลองเพื่อหาค่าศักย์ไฟฟ้าการ กัดกร่อน (Corrosion potential, E_{corr}) ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion current density, I_{cor}) และค่าอัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate, R_{mpy}) โดยประมวลผลจากรูปของเส้น โค้งโพ ลาไรเซชัน ดังแสดงในรูปที่ 3.18 โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Tafel จะทำให้ได้จุดตัดของ ค่าศักย์ไฟฟ้า การกัดกร่อน (E_{cor}) และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{cor})



รูปที่ 3.18 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

3.3.5 ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นผิวหลังทดสอบการกัดกร่อน

3.3.5.1 นำชิ้นงานภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนทำการตรวจสอบพื้นผิว (Surface) ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ร่วมด้วย เทกนิก EDS เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาก และร่องรอยที่ถูกกัดกร่อน

 3.3.5.2 นำชิ้นงานภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนทำการตรวจสอบผสมทางเคมี (Chemical composition) ของบริเวณที่ถูกกัดกร่อนของชิ้นงานด้วยเทคนิค Photoemission electron microscopy (PEEM)

บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 และเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ผ่านการเคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN) ได้แบ่งตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 (A4140) กลุ่มชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 เคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนาประมาณ 250 นาโนเมตร (TiAIN-250nm) กลุ่มชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 เคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนาประมาณ 500 นาโนเมตร (TiAIN-500nm) และกลุ่มชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 เคลือบไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์หนา ประมาณ 750 นาโนเมตร (TiAIN-750nm) โดยกลุ่มชิ้นงานดังกล่าวได้ทำการทดสอบการกัดกร่อนใน สารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีก่าพีเอช (pH) 2, 7 และ 10 ได้ผล การตรวจสอบผิวของตัวอย่างก่อนการทดสอบการกัดกร่อน ผลการทดสอบการกัดกร่อนของตัวอย่าง และผลการตรวจสอบผิวของตัวอย่างหลังการทดสอบการกัดกร่อนดังนี้

4.1 ผลการตรวจสอบฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า
AISI 4140 ก่อนการทดสอบการกัดกร่อน

4.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคพื้นผิว และตามแนวภาคตัดขวางของฟิล์ม บาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ ส่องกราดชนิดฟิลอิมิชชั่น (FE-SEM)

รูปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างจุลภาคพื้นผิว และภาคตัดขวางของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 พบว่าฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ มีลักษณะ เกรนเป็นแท่งรูปทรงกรวย (Columnar)เกรนมีการจัดเรียงตัวที่หนาแน่น จากรูปแสดงให้เห็นว่าพื้นผิว ชั้นเคลือบของชิ้นงาน TiAIN-250nm มีขนาดเกรนที่เล็กกว่าชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ตามลำดับ การโตของเกรนคอลัมนาร์หรือการเพิ่มความหนาของชั้นเคลือบ TiAIN ส่งผลให้ ขนาดเกรนเพิ่มขึ้นซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ(K.-D. Bouzakis et al., 2004)



TiAlN-750nm

รูปที่ 4.1 โครงสร้างจุลภาคพื้นผิว และภาคตัดขวางของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์



ค) TiAlN-750nm

รูปที่ 4.2 ภาพตัดขวางของเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ (TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) วิเคราะห์ความแปรปรวน ของส่วนผสมทางเคมีด้วยเทคนิค EDX นอกจากภาพโครงสร้างจุลภาคตัดขวางดังรูป 4.1 แล้ว ยังได้วิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนผสม ทางเคมีของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์เพิ่มเติม ดัง แสดงในรูปที่ 4.2 ตามแนวภาคตัดขวางของชิ้นงาน TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm โดยใช้เทคนิค EDXธาตุที่สนใจในการศึกษา คือ ในโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) อะลูมิเนียม (AI) ไทเทเนียม (Ti) และ เหล็ก (Fe) จากการวิเคราะห์พบว่าธาตุ ไทเทเนียม (Ti) อะลูมิเนียม (AI) และ ในโตรเจน (N) ซึ่งเป็นธาตุองค์ประกอบของชั้นเคลือบมีปริมาณค่อนข้างสูงและมีแนวโน้ม ลดลงเรื่อย ๆ จนไปถึงวัสดุพื้น ในทางกลับกันธาตุเหล็ก (Fe) เป็นธาตุองค์ประกอบหลักของวัสดุพื้น (AISI 4140) มีแนวโน้มก่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนถึงวัสดุพื้น แต่สำหรับธาตุออกซิเจน (O) เห็นได้ชัดเจนว่ามี การเปลี่ยนแปลงไม่มากสำหรับชิ้นงาน TiAIN-250nm และ TiAIN-500nm แต่ชิ้นงาน TiAIN-750nm ธาตุออกซิเจน (O) มีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงจนไปถึงชั้นของวัสดุพื้น ดังนั้นความหนาของฟิล์มที่ เพิ่มขึ้นสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ของธาตุเหล็กออกไปยังพื้นผิวของฟิล์ม ในทางกลับกันยังสามารถ ช่วยยับยั้งการแพร่ของธาตุออกซิเจน (O) เข้าไปยังวัสดุพื้น (Wongpinij, T. et al., 2012)



รูปที่ 4.3 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์เคลือบบนซิลิกอนเวเฟอร์

4.1.2 การวิเคราะห์ฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ด้วยเทคนิคเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD)

รูปที่ 4.3แสดงผลการวิเคราะห์ของฟิล์ม TiAIN เคลือบบนซิลิกอนเวเฟอร์ ที่มีความหนาของ ฟิล์มแตกต่างกัน ซึ่งความหนาของฟิล์ม TiAIN ควบคุมโดยเวลาที่ใช้ในการเคลือบ จากผลการ วิเคราะห์พบการปรากฏของสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ซึ่งอะตอมมีการจัดเรียง ด้วในระนาบ (111) ที่มุม 37.34 องศา ระนาบ (200)ที่มุม 42.80 องศาและระนาบ (220) ที่มุม 62.22 องศา ซึ่งโครงสร้างผลึกของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ในงานวิจัยนี้มีการจัดเรียงตัวใน ระนาบ (200) ชัดเจนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเรียงตัวในระนาบอื่น ๆจากการวิเคราะห์ผล ดังกล่าวสอดกล้องกับรายงานวิจัยของ (Kim, C.W. and Kim K.H., 1997 ; Adibi, F. and et al., 1993) โครงสร้างผลึกของฟิล์ม TiAIN ในงานวิจัยนี้มีการจัดเรียงตัวในระนาบ (200) ชัดเจนที่สุดเกิดจาก อัตราการไหลของ N₂ที่สูงกว่า 6 SCCM ในระหว่างขั้นตอนการเกลือบผิว (Shew, B.Y. and et al., 1997 ; Chakrabarti, K., 2002) นอกจากนี้ยังพบว่า ณ ตำแหน่งที่ปรากฏของสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ของชิ้นงาน TiAIN-750nm มีก่าความความเข้มของพลังงานสูงกว่าชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-250nm ตามลำดับ



รูปที่ 4.4 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม TiAIN (TiAIN-250nm) ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140



รูปที่ 4.5 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ TiAIN (TiAIN-500nm) ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140



รูปที่ 4.6 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์ม TiAIN (TiAIN-750nm) ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140

รูปที่ 4.4 ถึง 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ของฟิล์ม TiAIN เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ที่มี กวามหนาของฟิล์มแตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์พบว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm ปรากฏเฟสของ เหล็ก (Fe) ซึ่งอะตอมมีการจัดเรียงตัวในระนาบ (110) ที่มุม 44.75 องศา ระนาบ (200) ที่มุม 65.09 องศาและระนาบ (211) ที่มุม 82.35 องศา ผลการตรวจสอบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ไม่พบการปรากฏ ของสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ เนื่องจากเฟสของเหล็ก (Fe) ในโลหะพื้น (AISI 4140) มีค่าความเข้มของพลังงานสูงกว่าสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์จึงทำให้ผล การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ไม่ปรากฏสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์จึงทำให้ผล การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ไม่ปรากฏสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์จึงทำให้ผล การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ไม่ปรากฏสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์แต่สำหรับชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm พบผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่แตกต่างจากชิ้นงาน TiAIN-250nm คือปรากฏสารประกอบที่มุม 43.17 สำหรับ TiAIN-500nm และปรากฏสารประกอบที่มุม 42.96 องศา สำหรับ TiAIN-750nm เห็นได้ว่ามุมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสารประกอบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่มีการเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (200) ดังแสดงในรูปที่ 4.3 ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่มีค่าความเข้มของพลังงานสูงที่สุดในงานวิจัยนี้ (N.S. Patel and et al., 2010)

องค์ประกอบ	ตำแหน่งพีคหลัก 2Ø (องศา)	ตำแหน่งพืก	โครงสร้าง	ฐานข้อมูล
	/	(ระนาบ)		(ภาคผนวก ก)
Ti _{0.5} Al _{0.5} N	37.09 43.10 62.59	(111) (200) (220)	Cubic	97-060-8638
Fe	45.06 65.18 82.35	(110) (200) (211)	Cubic	00-001-1267
TiN	36.66 42.59 61.81	(111) (200) (220)	Cubic	38-1420

ตารางที่ 4.1 เฟสองค์ประกอบของผิวเคลือบ

ฟิล์มบางไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN) และไทเทเนียมไนตรายค์ (TiN) มี ระนาบการเลี้ยวเบนที่เหมือนกัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 แต่ตำแหน่งของพีค TiAIN มีตำแหน่งของ มุมการเลี้ยวเบนที่สูงกว่าตำแหน่งพีค TiN เนื่องจากอะตอมอะลูมิเนียมเข้าไปแทนที่อะตอมของ ไทเทเนียมในโครงสร้างของไทเทเนียมไนตรายค์ (H. Cheng-Hsun and et al., 2005)

4.2 ผลการทดสอบการกัดกร่อน

ผลการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 (A4140) และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) ที่มีความหนาของชั้นเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์ แตกต่าง กัน โดยชิ้นงานทั้งหมดได้ทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีค่าพีเอชเท่ากับ 2, 7 และ 10 ซึ่งจากการทดสอบด้วยเครื่องโพเทนชิโอสแตท เป็น วิธีตรวจสอบพฤติกรรมการกัดกร่อนด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เมื่อผ่านการประมวลผลจะได้รับผล การทดสอบเป็นเส้นโค้งโพลาไรเซชันดังแสดงในรูปที่ 4.7 ถึง 4.9

จากเส้นโด้งโพลาไรเซชันของขึ้นงานทั้งหมดนี้สามารถนำมาหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion potential, E_{orr}) ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็ม(Pitting potential, E_{pitt}) ค่าความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (Corrosion current density, I_{corr}) และสามารถนำค่าความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนที่ได้ไปคำนวณเพื่อหาค่าอัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate, R_{mm}) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 โดยวิธีการคำนวณหาค่าอัตราการกัดกร่อน (Corrosion rate, R_{mm}) ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 โดยวิธีการคำนวณหาค่าอัตราการกัดได้แสดงในภาคผนวก ข นอกจากนี้ผลต่างระหว่างก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็ม (E_{pitt}) และศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{corr}) ของระบบการกัดกร่อน ($\triangle E=E_{pit</sub>-E_{corr}) สามารถกำหนดเป็นความกว้างของช่วงที่โลหะไม่$ ว่องไวต่อการกัดกร่อนหรือช่วงเกิดพาสสีฟฟิล์ม (Passive region) โดยสาเหตุของการกัดกร่อนเกิดขึ้นได้จากทั้งโลหะ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในงานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อน ของชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 ที่ไม่ถูกเกลือบผิว (A4140) และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางใทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) ตลอดจนผลของกวามหนาของชั้นเกลือบ ใทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ และก่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองดังแสดงในหัวข้อต่อไปนี้



รูปที่ 4.7 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140, TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2



รูปที่ 4.8 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140, TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 7



รูปที่ 4.9 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน A4140, TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 10



ตารางที่ 4.2 ค่าที่ได้จากเส้นโพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว (A4140) และชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีค่า พีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10

จ้างงาวง			พีเ	อช 2				พีเอ	DV 7				พีเอ	ช 10	
มากมน	E _{corr}	I	E _{pit}	$\Delta E = E_{pit} - E_{corr}$	R _{mmy}	E _{corr}	I _{corr}	E _{pit}	$\triangle E = E_{pit} - E_{corr}$	R _{mmy}	E _{corr}	I	E _{pit}	$\Delta E = E_{pit} - E_{corr}$	R _{mmy}
A4140	-1020	6.0	-	-	0.0663	-1010	0.45	-208	802	0.0049	-998	0.4	-250	748	0.0044
TiAlN-250nm	-720	3.5	-	-	0.0179	-1114	0.55	-380	734	0.0021	-1089	1.7	-460	629	0.0065
TiAlN-500nm	-800	2.0	-	-	0.0076	-1082	0.45	-360	722	0.0022	-1061	1.05	-370	691	0.0046
TiAlN-750nm	-900	0.4	-540	360	0.0015	-1170	0.025	-177	993	9.6E-5	-1153	0.032	-255	898	0.0001

หมายเหตุ

- E_{corr} ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (มิลลิโวลต์)
- I_{corr} ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (ไมโครแอมป์/ตารางเซนติเมตร)
- E_{pit} ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้พาสสีฟฟิล์มแตกออก (มิลลิโวลต์)
- R_{mmy} ค่าอัตราการกัดกร่อน (มิลลิเมตร/ปี)

4.2.1 พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 และเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์

จากตารางที่ 4.2พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนา 750 นาโนเมตร (TiAIN-750nm) มีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการ ้กัดกร่อนต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว (A4140) ที่ทุกค่าพีเอช และชิ้นงาน เหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนา 250 และ 500 นาโนเมตร (TiAIN-250nm และ TiAIN-500nm) มีค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนต่ำกว่า ้ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว (A4140) ที่ค่าพีเอช 7 และ 10 แต่เนื่องจากฟิล์ม TiAIN มีน้ำหนักกรัมสมมูลย์ (5.65 กรัม) และความหนาแน่น (4.81 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่ำ กว่าเหล็กกล้ำ AISI 4140 (R. Linna., 2012) ซึ่งเหล็กกล้ำ AISI 4140 มีน้ำหนักกรัมสมมูลย์เท่ากับ 26.62 กรัม และความหนาแน่นเท่ากับ 7.87 กรัมต่อลกบาศก์เซนติเมตร เมื่อนำค่าความหนาแน่น กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน น้ำหนักกรัมสมมูลย์ และความหนาแน่น มาคำนวณค่าอัตราการกัดกร่อน พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้ำ AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม TiAIN มีอัตราการกัดกร่อนต่ำกว่าชิ้นงาน เหล็กกล้ำ AISI 4140 ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ (R.M. Souto and H. Alanyali.,2000; S. Liscano and et al., 2006) นอกจากนี้เส้น โค้ง โพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-250nm และ TiAIN-500nm ใน สารถะถายที่มีค่าพีเอช 7 และ10 ชิ้นงาน TiAIN-500nm และชิ้นงาน TiAIN-750nm ในสารละถายที่มี ้ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 ปรากฏช่วงที่โลหะไม่ว่องไวต่อการกัดกร่อนหรือช่วงพาสสีฟฟิล์ม (Passive region) ที่กว้างกว่าชิ้นงาน A4140 กล่าวคือ การที่ชิ้นงาน TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ปรากฏช่วงที่โลหะไม่ว่องไวต่อการกัดกร่อนที่กว้าง นั้นแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิว ้ด้วยฟิล์ม TiAIN มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีและเกิดพาสสีฟฟิล์มที่มีเสถียรภาพบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีของชิ้นงานที่เคลือบผิวด้วยฟิล์ม TiAlN (TiAlN-250nm. TiAIN-500 และ TiAIN-750nm) เป็นผลจากไทเทเนียมอะตอม และอะลมิเนียมอะตอมที่มีอย่ในฟิล์ม TiAIN หลังจากผิวฟิล์มทำปฏิกิริยากับสิ่งแวคล้อม (สารละลายโซเดียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก) เกิดออกไซด์ที่มีเสถียรภาพทำให้อัตราการกัดกร่อนเกิดขึ้นได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับ เหล็กกล้า AISI 4140 (ชิ้นงาน A4140)

4.2.2 พฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ที่มีความหนาแตกต่างกัน (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm)

รูปที่ 4.10 แสดงค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนา 750 นาโนเมตร (TiAIN- 750nm) มีก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูก เกลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หนา 500 และ 250 นาโนเมตร (TiAIN-500nm และ TiAIN-250nm) ตามลำดับ ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ (N.S. Patel and et al., 2010) เมื่อนำก่ากวามหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน น้ำหนักกรัมสมมูลย์ และความหนาแน่นไป กำนวณอัตราการกัดกร่อน พบว่าชิ้นงาน TiAIN-750nm มีอัตราการกัดกร่อนต่ำกว่า ชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-250nm ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.11 ที่ทุกก่าพีเอช



รูปที่ 4.10 ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงาน TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10



รูปที่ 4.11 ค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงาน TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก ที่ค่าพีเอช 2. 7 และ 10

โดยพฤติกรรมการกัดกร่อนของชั้นเคลือบที่มีความหนาต่างกัน อาจเป็นผลมาจากขนาดเกรน ของชั้นเคลือบ TiAIN และความเค้นตกค้าง (Residual stress) ของชั้นเคลือบเนื่องจากชั้นเคลือบของ ชิ้นงาน TiAIN-750nm มีขนาดเกรนที่ใหญ่กว่าชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-250nm ตามลำคับ ดังนั้นชั้นเคลือบของชิ้นงาน TiAIN-750nm จึงมีขอบเกรนน้อยว่าชั้นเคลือบของชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-250nm ตามลำคับ ขนาดเกรนที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ความต้านทานการกัดกร่อน เพิ่มขึ้น (S.E. Hernandez and et al., 1995) โดยการกัดกร่อนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่พื้นผิวที่เป็น จุคบกพร่อง เช่น รูพรุน ขอบเกรน และดิสโลเคชัน ซึ่งจากการทดสอบการกัดกร่อนพบว่าชิ้นงาน TiAIN-250 มีอัตราการกัดกร่อนสูงที่สุด และพบการหลุดลอกของชั้นฟิล์ม TiAIN นี้อาจเป็นผลมา จากปริมาณพื้นที่ของขอบเกรนที่มากขึ้น และฟิล์มที่บางมีความเค้นตกค้างสูงกว่าฟิล์มที่หนา (J.-H.Huang., F.-Y. Ouyang.and G.-P. Yu., 2007 ; N.S. Patel and et al., 2010) 4.2.3 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดย น้ำหนักที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด่

รูปที่ 4.10แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 มีค่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนสูงกว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำดับ เมื่อนำค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน น้ำหนักกรัมสมมูลย์ และความ หนาแน่น มากำนวณค่าอัตราการกัดกร่อน พบว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบในสารละลายที่ก่าพีเอช 2 มี อัตราการกัดกร่อนสูงกว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบในสารละลายที่ก่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำคับ ดังแสดง ในรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.12 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่าง TiAIN-250nm ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ10

นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานTiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nmเปลี่ยนแปลงตามค่าพีเอชของสารละลายที่ใช้ในการทคสอบการกัดกร่อนอย่าง ชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 4.12 ถึง 4.14โดยเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-250nm ที่ถูก ทคสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 ไม่พบช่วงพาสสีฟฟิล์ม (Passive region) สำหรับชิ้นงาน TiAIN- 250nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7 และ 10 นั้นปรากฏช่วงพาสสีฟฟิล์ม (Passive region) อย่างชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 4.12 ซึ่งชิ้นงาน TiAIN-250nm ที่ถูกทดสอบการกัดกร่อนในสารละลาย ที่ค่าพีเอช 7 (E_{pit} = -380 มิลลิโวลต์) มีค่าศักย์ใฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็มสูงกว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm ที่ถูกทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่มีค่าพีเอช 10 (E_{pit} = -460 มิลลิโวลต์) และจากผล ดังกล่าวพบว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7 (ΔE = 734 มิลลิโวลต์) ปรากฏช่วงพาสสีฟฟิล์ม(Passive region) ที่กว้างกว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm ที่ถูกทดสอบใน สารละลายที่ค่าพีเอช 10 (ΔE = 629 มิลลิโวลต์)



รูปที่ 4.13 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-500nm ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ก่าพีเอช 2, 7 และ 10

รูปที่ 4.13 แสดงเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 พบว่าลักษณะเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-500nm มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกับลักษณะเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานTiAIN-250nm คือ เส้นโค้ง โพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 ไม่ปรากฏช่วงที่ โลหะไม่ไวต่อการกัดกร่อน (Passive region) สำหรับชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบใน สารละลายที่ค่าพีเอช 7 และ 10 นั้นปรากฏช่วงที่โลหะไม่ไวต่อการกัดกร่อน (Passive region) ซึ่ง ชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7 (E_{pit}= -360 มิลลิโวลต์) มีค่าศักย์ไฟฟ้า ที่ทำให้พาสสีฟฟิล์มแตกออกใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 (E_{pit}= -370 มิลลิโวลต์) แต่ชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7($\Delta E = 722$ มิลลิ โวลต์) ปรากฏช่วงที่โลหะไม่ไวต่อการกัดกร่อน (Passive region) ที่กว้างกว่าชิ้นงาน TiAIN-500nm ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 10($\Delta E = 691$ มิลลิโวลต์)



รูปที่ 4.14 แสดงเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน TiAIN-750nm ที่ถูกทคสอบในสารละลาย ที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 พบว่าเส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงานTiAIN-750nm ปรากฏช่วงพาสสีฟ ฟิล์ม (Passive region) ที่ทุกค่าพีเอช ซึ่งชิ้นงาน TiAIN-750nm ที่ถูกทคสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7 (E_{pit} = -177 มิลลิโวลต์) มีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็มสูงกว่าชิ้นงาน TiAIN-750nm ที่ถูก ทคสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 (E_{pit} = -255 มิลลิโวลต์) และ 2 (E_{pit} = -540 มิลลิโวลต์) ตามลำคับ นอกจากนี้พบว่าชิ้นงาน TiAIN-750nm ที่ถูกทคสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 7 ($\Delta E = 993$ มิลลิโวลต์) ปรากฏช่วงพาสสีฟฟิล์ม (passive region) กว้างกว่าชิ้นงาน TiAIN-750nm ที่ถูกทคสอบ ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 ($\Delta E = 898$ มิลลิโวลต์) และ 2 ($\Delta E = 360$ มิลลิโวลต์) ตามลำคับ งากผลของอัตราการกัดกร่อน ค่าศักข์ไฟฟ้าการกัดกร่อนแบบรูเข็ม และความกว้างของช่วง พาสสีฟฟิล์ม (Passive region) บนเส้น โค้งโพลาไรเซชันแสดงให้เห็นว่าสารละลายที่ค่าพีเอช 2 ส่งผล ให้ชิ้นงานมีการกัดกร่อนรุนแรงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายที่ค่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากคลอไรด์ไอออน (CI) ในสารละลาย กล่าวคือ ที่ค่าพีเอช 2 ได้ปรับค่าพีเอชของ สารละลายฯ โดยใช้กรดไฮโดกลอริก (HCI) ทำให้มีปริมาณกลอไรด์ไอออน (CI) ในสารละลายเพิ่ม มากขึ้นส่งผลให้พาสสีฟฟิล์มแตกได้ง่ายขึ้น(A.A. Mazhar and et al., 2011; T. Christine and R.P. Alan., 2005) และชิ้นงาน TiAIN-250, TiAIN-500 และ TiAIN-750 ที่ถูกทดสอบในสารละลายที่พีเอช 7 แสดงช่วงพาสสีฟฟิล์ม(Passive region) กว้างกว่าชิ้นงานที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ ค่าพีเอช 10 และ 2 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าพาสสีฟฟิล์มที่เกิดขึ้นในสารละลายพีเอช 7 มีความ ต้านทานการกัดกร่อนที่ดีหรือเป็นฟิล์มที่มีเสถียรภาพสูง (S.M. Bhola S.M. and B. Mishra., (2013) ; L.Y. Xu and et al., 2013) ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นผลจากอะลูมิเนียมออกไซด์ที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการกัดกร่อน ซึ่งอะลูมิเนียมออกไซด์มีความด้านทานการกัดกร่อนหรือมีเสถียรภาพใน สารละลายที่มีค่าพีเอช 5 ถึง 8 (S. Gaute., 2003)

4.3 คุณลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และชิ้นงานเหล็กกล้า
AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายด์ หลังทดสอบการกัดกร่อน

 4.3.1 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หลังการทดสอบ การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ10 ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (SEM)



A4140 ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10

TiAIN-250mm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10

รูปที่ 4.15 ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน A4140 และ TiAlN-250nm หลังการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก ที่มีค่าพีเอช 2, 7 และ 10



TiAIN-500nm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10

TiAIN-750mm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10

รูปที่ 4.16 ลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-500 และ TiAIN-750nm หลังการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก ที่มีค่าพีเอช 2, 7 และ 10

รูปที่ 4.15 และ 4.16 แสดงภาพลักษณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูก เกลือบ (A4140) และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเกลือบผิวด้วยฟิล์ม TiAIN (TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) ในสารละลายโซเดียมกลอไรด์กวามเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดย น้ำหนัก ที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 พบว่าพื้นผิวของชิ้นงานที่ไม่เคลือบผิวเกิดการกัดกร่อน (A4140) มี ผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนเกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานมากกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม TiAIN ที่ทุก พีเอช อาจเป็นผลจากชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบผิว (A4140) เป็นชิ้นงานเปลือยหลังทดสอบการ กัดกร่อนเกิดฟิล์มที่ไม่มีเสถียรภาพไม่สามารถป้องกันการกัดกร่อนจากสารละลาย พื้นผิวจึงถูก กัดกร่อนจากสารละลายได้ง่ายกว่าชิ้นงานที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม TiAIN ส่วนกลุ่มของชิ้นงานที่ เคลือบ TiAIN ที่ความหนาต่างกัน (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) พบว่าพื้น ผิวชิ้นงาน TiAIN-250nm เกิดการกัดกร่อนและมีผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนเกิดขึ้นบนผิวชิ้นงานมากกว่า ชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ตามลำดับ ที่ทุกพีเอช



TiAlN-250nm

TiAlN-500nm

รูปที่ 4.17 ภาพถ่าย SEM ของชิ้นงาน TiAIN-250nm และ TiAIN-500nm หลังทคสอบการกัคกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โคยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2

^{าย}าลัยเทคโนโลยี^ณ์

นอกจากนี้ยังพบว่าฟิล์ม TiAIN ของชิ้นงาน TiAIN-250nm และ TiAIN-500nm ที่ทดสอบ การกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 พบรอยแตกบนผิวฟิล์ม TiAIN ดังแสดงในรูปที่ 4.17 อาจเป็น ผลเนื่องจากชิ้นงาน TiAIN-250nm มีปริมาณขอบเกรนที่มากกว่าชิ้นงาน TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ตามลำดับ เป็นสาเหตุให้สารละลายสามารถแทรกซึมผ่านชั้นฟิล์มเข้าไปกัดกร่อนผิววัสดุพื้น ได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดรอยแตกบนผิวฟิล์มและหลุดออกจากผิววัสดุพื้น (AISI 4140) และอาจเป็นผลของ ค่ากวามเป็น กรด-ค่าง (pH) ของสารละลายที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนร่วมด้วยจากการทดสอบ การกัดกร่อนพบว่าชิ้นงานที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 เกิดการกัดกร่อนและมีผลิตภัณฑ์ การกัดกร่อนเกิดขึ้นบนพื้นผิวชิ้นงานมากกว่าชิ้นงานที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำดับ สำหรับทุกชิ้นงาน (A4140, TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm) ทั้งนี้อาจ เป็นผลเนื่องมาจากพาสสีฟฟิล์มที่เกิดขึ้นมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีหรือเป็นฟิล์มที่มีเสถียรภาพ สูงในสารละลายที่ค่าพีเอช 7

4.3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงานภายหลังทดสอบการกัดกร่อนด้วย เทคนิค EDX

หลังทดสอบการกัดกร่อนได้ตรวจองค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยเทคนิค EDX ของ บริเวณกัดกร่อนและบริเวณที่ไม่กัดกร่อนบนผิวชิ้นงาน เพื่อให้เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบ ทางเคมีหลังทดสอบการกัดกร่อนระหว่างบริเวณที่เกิดกัดกร่อนและไม่กัดกร่อน โดยตรวจสอบ ส่วนผสมทางเคมีบนพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-250nm (ซึ่งเป็นชิ้นงานเหล็ก AISI 4140 ที่เคลือบ TiAIN บาง ที่สุด) และ TiAIN-750nm (ซึ่งเป็นชิ้นงานเหล็ก AISI 4140 ที่เคลือบ TiAIN หนาที่สุด) หลังทดสอบการ กัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ค่าพีเอช 2, 7 และ 10 ดัง แสดงในรูปที่ 4.18 ถึง 4.23 ตามลำดับ

หลังการตรวจสอบส่วนผสมทางเกมีบนพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-250nm พบว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm ณ บริเวณที่เกิดการกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อน (บริเวณ 1) มืองค์ประกอบของธาตุ เหล็ก (Fe) และออกซิเจน (O) เป็นส่วนผสมทางเกมีหลัก ซึ่งธาตุ Fe และ O ที่พบอาจเป็นส่วนผสม ทางเกมีของเหล็กออกไซด์หรือสนิมเหล็กที่เกิดจากสารละลายเข้าไปกัดกร่อนโดยตรงที่ผิววัสดุพื้น (AISI 4140) และเกิดจากการแพร่ซึมของสารละลายผ่านตามขอบเกรนของฟิล์มไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ เข้าไปกัดกร่อนผิววัสดุพื้นจนเกิดเป็นเหล็กออกไซด์ขึ้นบนผิวชิ้นงาน

สำหรับบริเวณที่ไม่เกิดกัดกร่อน (บริเวณ 2) หลังการตรวจสอบพบองค์ประกอบของธาตุ เหล็ก (Fe) ในโตรเจน (N) ไทเทเนียม (Ti) อะลูมิเนียม (Al) และ ออกซิเจน (O) เป็นส่วนผสมทางเคมี หลัก ซึ่งสามารถระบุได้ว่าบริเวณนี้อาจไม่เกิดการกัดกร่อนหรือเกิดการกัดกร่อนที่ไม่รุนแรงจนทำให้ ฟิล์มไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ หลุดออกจากผิววัสดุพื้น ดังแสดงในรูปที่ 4.18 ถึง 4.20



Element	Weight %	Element	Weight %
ок	40.45	NK	4.84
NaK	1.03	ок	6.78
A1 K	0.32	AIK	1.57
SiK	0.32	SiK	0.31
CIK	0.92	Ti K	5.38
Ti K	0.42	Cr K 9	1.02
Cr K	0,42	Mn K	0.72
Fe K	55.27 1881	Fe K	79.37
totals	100	totals	100

รูปที่ 4.18 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAlN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ก่าพีเอช 2



ก) ภาพถ่าย SEM ชิ้นงาน TiAIN-250nm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 7

Element	Weight %	Element	Weight %
ОК	34.88	8 N K	
A1 K	0.20	ок	7.59
TiK	4.76	AIK	2.34
Cr K	0.62	SiK	0.24
MnK	0.49	Ti K	9.89
Fe K	59.05	Cr K	1.00
totals	100	FeK	67.31
	TOTABLE	totals	100

ข)ส่วนผสมทางเคมีบริเวณ 1 ค)ส่วนผสมทางเคมีบริเวณ 2

รูปที่ 4.19 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 7



Element	Weight %	Element	Weight %
ок	34.98	N K	6.26
A1 K	0.60	ок	6.60
SiK	0.22	AIK	1.21
TiK	3.08	Si K	0.27
Cr K	0.68	ТіК	6.77
MnK	0.64	Cr K	0.92
Fe K	59.80	MnK	0.73
totals	100	Fe K	77.24
	10	totals	100

รูปที่ 4.20 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-250nm หลังทดสอบการกัดกร่อนที่ค่าพีเอช 10

กรณีของชิ้นงาน TiAlN-750nm พบว่า ณ บริเวณการกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์การกัดกร่อน (บริเวณ 1) ที่เกิดขึ้นมีองค์ประกอบของธาตุเหล็ก (Fe) ไทเทเนียม (Ti) อะลูมิเนียม (Al) และ ออกซิเจน (O) เป็นส่วนผสมทางเคมีหลัก ดังแสคงในรูปที่ 4.21 ถึง 4.23 ออกไซด์ที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็น ้ส่วนผสมทางเกมีของ เหล็กออกไซด์ ไทเทเนียมออกไซด์ และอะลุมิเนียมออกไซด์ หรืออางเกิด ออกไซด์ขึ้นได้ทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากชั้นฟิล์ม TiAIN ที่หนามากขึ้นส่งผลให้สามารถช่วยยับยั้งการ แพร่ของสารละลายเข้าไปกัดกร่อนที่ผิววัสดุพื้น ในทางกลับกันยังสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ของธาตุ เหล็กออกไปยังพื้นผิวของฟิล์ม TiAIN ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่พื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-750nm มี ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) น้อยกว่ากลุ่มชิ้นงาน TiAIN-250nm (Wongpinij, T. et al., 2012) สำหรับ บริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 2) หลังการตรวจสอบพบองค์ประกอบของธาตเหล็ก (Fe) ์ ใทเทเนียม (Ti) อะลูมิเนียม (Al) ในโตรเจน (N) และ ออกซิเจน (O) เป็นส่วนผสมทางเคมีหลักซึ่ง ้สามารถระบุได้ว่าบริเวณนี้อางไม่ได้เกิดการกัดกร่อนหรือเกิดการกัดกร่อนที่ไม่รุนแรง นอกงากนี้ ้ยังพบว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm และ TiAIN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารลายที่ค่าพีเอช 2 พบองค์ประกอบของธาต คลอรีน (Cl) บริเวณที่เกิดการกัดกร่อนและผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อน (บริเวณ 1) ซึ่งเป็นที่ทราบคีว่า คลอไรค์ไอออน (CI) ในสารละลายกระต้นให้การแตกสลายของ พาสสีฟฟิล์มเพิ่มขึ้น และเมื่อพาสสีฟฟิล์มแตกส่งผลให้สารละลายเข้าไปกัดกร่อนผิววัสดุพื้นได้ ้โดยง่ายจึงทำให้บริเวณรอยแตกของพาสสีฟฟิล์ม พบผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ดัง แสดงในรูปที่ 4.19 (TiAIN-250nm) และ 4.22 (TiAIN-750nm) หลังทดสอบการกัดกร่อนใน สารละลายที่ค่าพีเอช 7 พบว่าบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 2) มีปริมาณธาตุอะลูมิเนียม (Al) มากกว่าชิ้นงานที่ทคสอบในสารถายที่ค่าพีเอช 2 และ 10 ในทางกลับกันพบว่าบริเวณที่เกิดการ กัดกร่อนและผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อน (บริเวณ 1) มีปริมาณชาตุอะลูมิเนียม (Al) ที่น้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับชิ้นงานหลังทคสอบการกัดกร่อนในสารลายที่ค่าพีเอช 2 และ 10 ผลดังกล่าวสามารถ ้ยืนยันได้ว่าอะลูมิเนียมออกไซด์ที่เกิดขึ้นมีความต้านทานการกัดกร่อนหรือมีเสถียรภาพในสารละลาย ที่มีค่าพีเอช 7



ก) ภาพถ่าย SEM ชิ้นงาน Ti AIN-750mm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 2

Element	Weight %	Element	Weight %
ОК	41.66	NK	10.35
NaK	0.34	ОК	7.07
A1 K	2.03	AIK	3.31
CİK	1.51	SiK	0.58
Ti K	11.13	Tik 🖉	11.63
Cr K	1.97	Cr K	1.93
Fe K	41.36	MnK	0.50
totals	100	Fe K	64.62
		totals	100

รูปที่ 4.21 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2
		บริเวณ 1
		บริเวณ 2
		Haram T

Element	Weight %	Element	Weight %
ок	32.01	NK	16.07
NaK	0.43	ок	7.61
Al K	0.31	AIK	4.02
SiK	0.18	TiK	18.75
Ti K	6.32	Cr K	0.70
Cr K	0.65	MnK	0.48
MnK	0.61	FeK	52.37
Fe K	59.48 8120	no U totals	100
totals	100		

รูปที่ 4.22 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห้องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAlN-750nm หลังทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ก่าพีเอช 7



ก) ภาพถ่าย SEM ชิ้นงาน TiAIN-750nm ในสารละลายที่ค่าพีเอช 10

Element	Weight %	Element	Weight %
ок	37.66	NK	18.26
NaK	0.50	οк	5.73
Al K	1.06	AIK	2.37
SiK	0.31	SiK	0.20
ті к	8,69	Ti K	21.38
Cf K	6.12	Cr K	0.72
Fe K	45.66	Mn K	0.45
totals	100ຍາລັຍແ	olulaFex	50.89
		totals	100

รูปที่ 4.23 ภาพถ่าย SEM และผลการวิเคราะห์องก์ประกอบทางเคมีบนพื้นผิวของชิ้นงาน TiAIN-750nm หลังทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 10



รูปที่ 4.24 พื้นผิวชิ้นงานหลังการทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิค X-PEEM

4.3.3 การวิเคราะห์ลักษณะผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าและชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์หลังการทดสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค X-PEEM

รูปที่ 4.24 แสดงภาพถ่ายของพื้นผิวชิ้นงาน A4140, TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 ซึ่งเป็นค่าพีเอชของสารละลายที่เกิดการกัดกร่อนรุนแรง ด้วยเทคนิค X-PEEM โดยผู้วิจัยมีความสนใจสึกษาพลังงานของธาตุเหล็ก (Fe) ที่ระดับพลังงาน 700-730 อิเล็กตรอนโวลต์ (Fe L₃-edge) ซึ่งธาตุเหล็ก (Fe) เป็นส่วนผสมหลักของวัสดุพื้น (AISI 4140) และพลังงานของธาตุ ใทเทเนียม (Ti) ที่ระดับพลังงาน 440-480 อิเล็กตรอนโวลต์ (Ti L-edge) ซึ่งธาตุไทเทเนียม (Ti) เป็น ส่วนผสมหลักของชั้นเคลือบ TiAIN ภาพถ่ายจากเทคนิค X-PEEM พบว่าพื้นผิวของชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 (A4140) มีสีขาวทั่วทั้งพื้นผิว (สว่าง) ที่ระดับพลังงาน 700-730 อิเล็กตรอน โวลต์ (Fe L₃-edge) และเมื่อตรวจสอบที่ระดับพลังงาน 440-480 อิเล็กตรอนโวลต์ (Ti L-edge) พบว่า พื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าAISI 4140 (A4140) มีสีดำทั่วทั้งพื้นผิวเนื่องจากตรวจไม่พบไทเทเนียม บนพื้นผิวชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 4.25 ก)

สำหรับชิ้นงาน TiAIN-250nm ได้แสดงข้อได้เปรียบของภาพถ่ายจากเทคนิค X-PEEM ได้ ้อย่างชัดเจน โดยปกติภาพถ่ายที่ได้รับจาก SEM หรือกล้องจุลทรรศน์ สามารถบอกเพียงลักษณะ ้พื้นผิวของชิ้นงานที่เกิดขึ้น เช่น รอยแตก รูพรูน ขนาด และผลิตภัณฑ์จากการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่สำหรับภาพถ่ายจากเทคนิค X-PEEM ของชิ้นงาน TiAlN-250nm หลังทคสอบการกัดกร่อนใน สารละลายที่ค่าพีเอช 2 เมื่อทำการตรวจสอบที่ระดับพลังงาน700-730 อิเล็กตรอน โวลต์ (Fe L,-edge) พบว่าชิ้นงานมีพื้นสีขาว (สว่าง) มากกว่าพื้นที่สีดำ (ไม่สว่าง) ในทางกลับกันเมื่อทำการตรวจสอบที่ ระดับพลังงาน 440-480 อิเล็กตรอนโวลต์ (Ti L-edge) พบว่าชิ้นงานมีพื้นสีดำ (ไม่สว่าง) ณ บริเวณที่ ้สว่างในการตรวจสอบที่ระดับพลังงาน700-730 อิเล็กตรอนโวลต์ (Fe L,-edge) และพบว่าพื้นผิว ณ บริเวณที่มีสีดำ (ไม่สว่าง) ในการตรวจสอบที่ระดับพลังงาน700-730 อิเล็กตรอนโวลต์ (Fe L,-edge) เปลี่ยนเป็นพื้นผิวสีขาว (สว่าง) จากการวิเคราะห์ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชั้นเคลือบ TiAIN มีการ หลุดออกในลักษณะเป็นแผ่นจากวัสดุพื้นและยังคงเหลือส่วนที่เป็นชั้นเคลือบ TiAlN อยู่ ดังแสดงใน รูปที่ 4.24 ข) สำหรับผลภาพถ่ายของชิ้นงาน TiAlN-500nm จากเทคนิค X-PEEM แสดงให้เห็นว่ายัง ้เหลือพื้นที่ของชั้นเคลือบ TiAIN มากกว่าชิ้นงาน TiAIN-250nm และชั้นเคลือบ TiAIN มีลักษณะถูก กัดกร่อนเป็นหลุม นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบบนพื้นผิวชั้น เกลือบ TiAIN ดังแสดงในรูปที่ 4.24 ค) และสุดท้ายผลภาพถ่ายของชิ้นงาน TiAIN-750nm จาก ์ เทกนิก X-PEEM แสดงให้เห็นว่าชั้นเกลือบ TiAlN มีการหลุดออก หรือแตกออก แต่ไม่ถึงวัสคุพื้น และบริเวณรอยแตกยังพบเหล็กซึ่งหมายความว่าเหล็กมีการแพร่ออกจากวัสคุพื้นคังแสคงในรูปที่ 4.24)



รูปที่ 4.25 สเปกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-500nm หลังการทคสอบการกัดกร่อน ในสารละลายฯ ที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิก XAS



รูปที่ 4.26 สเปกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-500nm หลังการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายฯ ที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิก XAS



รูปที่ 4.27 สเปกตรัมของพื้นผิวชิ้นงาน TiAlN-750nm หลังการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายฯ ที่พีเอช 2 ด้วยเทคนิก XAS

ชิ้นงานในกลุ่ม TiAIN ที่ผ่านการทคสอบการกัดกร่อนถูกเลือกเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค X-PEEM ร่วมกับการวิเคราะห์สเปกตรัมของการดูดกลื่นรังสีเอ็กซ์ (X-ray absorption spectroscopy ; XAS) เนื่องจากชิ้นงานในกลุ่ม TiAIN มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่เคลือบ TiAIN (A4140) และชิ้นงานดังกล่าวมีพฤติกรรมการกัดกร่อนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อชิ้นงานมีความ หนาของชั้นเคลือบ TiAlN แตกต่างกัน (TiAlN-250nm, TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm) กล่าวคือ ชิ้นงาน TiAlN-250nm มีอัตราการกัดกร่อนสูงกว่าชิ้นงาน TiAlN-500nm และ TiAlN-750nm ตามลำคับ นอกจากนี้ชิ้นงานกล่ม TiAIN มีการเกิดของพาสสีฟฟิล์มขึ้นคังนั้นจึงเป็นจดที่น่าสนใจ ในการนำมาศึกษาครั้งนี้บริเวณที่ถูกตรวจสอบด้วยเทคนิค X-PEEM และ XAS ในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 บริเวณคือ บริเวณที่ไม่ถูกการกัดกร่อนกำหนดเป็น บริเวณ 1 และบริเวณที่ถูกกัดกร่อนกำหนดเป็น บริเวณ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4.25 ถึง 4.27 โดยทำการตรวจสเปกตรัมด้วยเทคนิค XAS ที่ระดับพลังงาน ้ดังต่อไปนี้ พลังงานของธาตุไทเทเนียม (Ti) ที่ระดับพลังงาน 450-468 อิเล็กตรอนโวลต์(Ti L-edge) พลังงานของธาตุในโตรเจน (N) ที่ระดับพลังงาน 390-420 อิเล็กตรอนโวลต์ (N K-edge) และ พลังงานของธาตุอะลูมิเนียม (Al)ที่ระดับพลังงาน 60-120 อิเล็กตรอนโวลต์(Al K-edge) ซึ่งเป็น องค์ประกอบหลักของชั้นเคลือบ TiAIN นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจที่ระดับพลังงาน 703-727 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นระดับพลังงานของธาตุเหล็ก (Fe L₃-edge) องค์ประกอบหลักของวัสดุพื้น (AISI 4140) และที่ระดับพลังงาน 520-546 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นระดับพลังงานของธาตออกซิเจน (O K-edge) องค์ประกอบหลักของออกไซค์พบว่าบนพื้นผิวชิ้นงาน TiAIN-250nm ปรากฏสเปกตรัม ของธาตุเหล็ก (Fe) อย่างชัดเจนที่บริเวณ 2 (บริเวณที่ชั้นเกลือบเกิดการกัดกร่อน) และพบสเปกตรัม ้ของออกซิเจนทั้งบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 1) และบริเวณที่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 2) นอกจากนี้ยังพบว่า ณ บริเวณ 1 (บริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน) ปรากฏธาตุ ในโตรเจน (N) และ ใทเทเนียม (Ti) เท่านั้นดังแสดงในรูปที่ 4.25

สำหรับผลการตรวจสเปกตรัมด้วยเทคนิก XAS ของชิ้นงาน TiAIN-500nm และTiAIN-750nm ดังแสดงในรูปที่ 4.26 และ 4.27 ปรากฏสเปกตรัมของเหล็ก (Fe) อย่างชัดเจนที่บริเวณ 2 (บริเวณที่ชั้นเคลือบเกิดการกัดกร่อน) จากผลสเปกตรัมชาตุเหล็ก (Fe) ของชิ้นงาน TiAIN-250nm TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm พบว่าสเปกตรัมของเหล็กมีความเข้มลดลงเมื่อความหนาของชั้น เกลือบ TiAIN เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.25 ข), 4.26 ข) และ 4.27 ข) และยังพบออกซิเจน (O) ในโตรเจน (N) และไทเทเนียม (Ti) ทั้งบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 1) และบริเวณที่เกิดการ กัดกร่อน (บริเวณ 2) แต่จากผลของสเปกตรัมแสดงให้เห็นว่าบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 1) ของออกซิเจน (O) ในโตรเจน (N) และไทเทเนียม (Ti) ต่ำกว่าบริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน (บริเวณ 1) จากผลดังกล่าวสามารถใช้ยืนยันได้ว่า ชั้นเกลือบ TiAIN ของชิ้นงาน TiAIN-500nm และTiAIN-750nm มีการหลุดออกหรือแตกออกแต่ไม่ถึงวัสดุพื้น นอกจากนี้ยังพบว่าธาตุในโตรเจน (N) ใทเทเนียม (Ti) และออกซิเจน (O) มีความเข้มเพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของชั้นเกลือบ TiAIN เพิ่มขึ้น ทั้ง บริเวณ 1 (บริเวณที่ไม่เกิดการกัดกร่อน) และบริเวณ 2 (บริเวณที่ชั้นเคลือบ TiAIN เพิ่มขึ้น ทั้ง หมายความว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานคือ ไทเทเนียม (Ti) และในโตรเจน (N) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นเคลือบ TiAIN และความหนาของชั้น เคลือบ (E. Guiot and et al., 1999 ; B.H. Frazer and et al., 2003 ; R.K. Hocking and et al., 2006 ; E.C. Wasinger and et al., 2003 ; W.S. Yoon and et al.,2002 ; F. Esaka and et al., 1997and Schedel-Niedring., 1998) ในงานวิจัยนี้ไม่พบธาตุอะลูมิเนียม (AI) โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XAS แต่พบ ธาตุอะลูมิเนียม (AI) โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDX นี้อาจเป็นเพราะปริมาณของอะลูมิเนียมที่ น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของ ไทเทเนียมและ ในโตรเจนของชั้นเคลือบ ดังแสดงในตาราง ที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ส่วนผสมเกมีของชั้นเกลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ (at.%)

	ไทเทเนียม (Ti)	อะลูมิเนียม (Al)	ในโตรเจน (N)
ชั้นเคลือบ TiAlN	32.05	6.42	61.53

จากผลของสเปกตรัมเกิดจากธาตุไทเทเนียมจากเนื้อฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นสารประกอบไทเทเนียมออกไซด์ (TiO_x) โดยสารประกอบชนิดนี้ เป็นฟิล์มที่สามารถด้านทานการกัดกร่อนได้ดี (I. Preda and et al., 2005) และสเปกตรัม XAS ของ เหล็ก (Fe) ที่ระดับพลังงาน 703-727 อิเล็กตรอนโวลต์ (Fe L₃-edge) มีความเข้มลดลงเมื่อความหนา ของชั้นเคลือบ TiAIN เพิ่มขึ้น และพบออกซิเจน (O) ที่ระดับพลังงาน 520-546 อิเล็กตรอนโวลต์ (O K-edge) ที่บริเวณ 2 (บริเวณที่ชั้นเคลือบเกิดการกัดกร่อน) (R.K. Hocking and et al., 2006 and E.C. Wasinger and et al., 2003) กาดว่าออกซิเจนตรงบริเวณที่เกิดการกัดกร่อนน่าจะมาจากการ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับธาตุเหล็ก (Fe) เป็นผลให้เกิดสารประกอบในฟอร์มของ Fe_xO_y บนผิวของ ชิ้นงาน (J.P. Crocombette and et al., 1994) สรุป

5.1 จากการศึกษาฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI 4140 ก่อน การทดสอบการกัดกร่อน สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

5.1.1 จากผลการวิเคราะห์ด้วยด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราคชนิดฟิลอิมิชชั่น (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) พบว่าฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ มี ลักษณะเกรนเป็นแท่งรูปทรงกรวย (Columnar) โดยการเพิ่มความหนาของชั้นเคลือบส่งผลให้ขนาด เกรนใหญ่ขึ้น

5.1.2 จากผลการวิเคราะห์ฟิล์ม TiAIN ที่ถูกเคลือบบนซิลิกอนเวเฟอร์ ด้วยเทคนิค XRD พบว่าฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ มีโครงสร้างผลึกระนาบ (111) ที่มุม 37.34 องศา ระนาบ (200) ที่มุม 42.80 องศาและระนาบ (220) ที่มุม 62.22 องศา โดยมีการจัดเรียงตัวในระนาบ (200) ชัดเจนที่สุด

5.1.3 จากผลการวิเคราะห์ฟิล์ม TiAIN ที่ถูกเคลือบบนเหล็กกล้ำ AISI 4140 พบว่าชิ้นงาน ที่เคลือบ TiAIN หนา 250 นาโนเมตร ไม่ปรากฏเฟสของ TiAIN แต่ปรากฏเฟสของเหล็ก (Fe) ที่มีการ จัดเรียงตัวในระนาบ (110) ที่มุม 44.75 องศา ระนาบ (200) ที่มุม 65.09 องศาและระนาบ (211) ที่มุม 82.35 องศา เมื่อความหนาของฟิล์ม TiAIN เพิ่มขึ้นพบฟิล์ม TiAIN มีโครงสร้างผลึกระนาบ (200) นอกจากนี้ยังพบว่าก่าความเข้มพลังงานของเฟสเหล็ก (Fe) ลดลงเมื่อความหนาของฟิล์ม TiAIN เพิ่มขึ้น

5.2 จากการศึกษาอิทธิพลความหนาของฟิล์ม TiAIN ที่เคลือบบนเหล็กกล้า AISI4140 และค่า ความเป็น กรด-ด่าง (pH) ของสารละลายในการทดสอบการกัดกร่อนที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน ของชิ้นงาน สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

5.2.1 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม อะลูมิเนียม-ในตรายด์ มีอัตราการกัดกร่อนต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิวที่ทุกค่าพีเอช (พี เอช 2, 7 และ 10)

5.2.2 ความต้านทานการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วย ฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายค์ เพิ่มขึ้นเมื่อความหนาของฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ใน ตรายค์ เพิ่มขึ้น 5.2.3 ชิ้นงานที่ถูกทดสอบในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 เกิดการกัดกร่อนรุนแรงที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับสารละลายที่ค่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำดับ ทั้งชิ้นงานที่ไม่เคลือบ TiAIN และ ชิ้นงาน ที่เคลือบ TiAIN นอกจากนี้ยังพบว่าพาสสีฟฟิล์มที่เกิดขึ้นบนฟิล์ม TiAIN มีความต้านทานการ กัดกร่อนหรือมีเสถียรภาพในสารละลายที่มีค่าพีเอช 7

5.2.4 ชิ้นงานที่ถูกทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่มีความพีเอช 2 มีพื้นที่ถูกกัดกร่อน และปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนมากกว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่มีความ พีเอช 10 และ 7 ตามลำคับ

5.3 จากการศึกษาคุณลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และชิ้นงาน เหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ หลังทดสอบการ กัดกร่อน สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

5.3.1 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทเนียม อะลูมิเนียม-ในตรายด์ มีพื้นที่ถูกกัดกร่อนและปริมาณผลิตการกัดกร่อนต่ำกว่าชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ไม่ ถูกเคลือบผิวที่ทุกค่าพีเอช (พีเอช 2, 7 และ 10)

5.3.2 พื้นที่ถูกกัดกร่อนและปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนลดลงเมื่อความหนาของฟิล์ม TiAIN เพิ่มขึ้นที่ทุกค่าพีเอช (พีเอช 2, 7 และ 10)

5.3.3 ชิ้นงานที่ถูกทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 2 มีพื้นที่ถูกกัดกร่อนและ ปริมาณผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนมากกว่าชิ้นงานที่ถูกทคสอบการกัดกร่อนในสารละลายที่ค่าพีเอช 10 และ 7 ตามลำดับ

5.3.4 หลังทดสอบการกัดกร่อนพบว่าพื้นผิวของชิ้นงานที่เคลือบฟิล์ม TiAIN หนาที่สุดมี ปริมาณชาตุเหล็ก (Fe) น้อยกว่ากลุ่มชิ้นงานที่ถูกเคลือบฟิล์ม TiAIN บางที่สุดที่ทุกก่าพีเอช (พีเอช 2, 7 และ 10)

5.3.5 จากผลภาพถ่ายพื้นผิวชิ้นงานหลังทคสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค X-PEEM พบว่า ชิ้นงานที่เคลือบฟิล์ม TiAIN บางที่สุดมีการหลุดออกของฟิล์ม TiAIN ในลักษณะเป็นแผ่นจากวัสดุ พื้น

5.3.6 จากผลของสเปกตรัมของ Ti L-edge และ Fe L_3 -edge ด้วยเทคนิค XAS พบ สารประกอบไทเทเนียมออกไซด์ (TiO_x) บนชิ้นงานที่ถูกเคลือบฟิล์ม TiAIN ซึ่งสามารถด้านทานการ กัดกร่อนได้ดี นอกจากนี้ยังพบสเปกตรัมของ Fe L_3 -edge มีความเข้มลดลงเมื่อความหนาของชั้น เกลือบ TiAIN เพิ่มขึ้น โดยสเปกตรัมของ Fe L_3 -edge ณ บริเวณที่ชั้นเคลือบเกิดการกัดกร่อนคาดว่า เกิดสารประกอบในฟอร์มของ Fe_xO_y บนผิวของชิ้นงาน

บรรณานุกรม

- ภาณุพงศ์ กอปรศรีสวัสดิ์. (2544).ผลของในโตรเจนต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า ใร้สนิมชนิดออสเตนนิติกเกรด304L. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประทีป วงศ์บัณฑิต: "การสร้างแผนภูมิพอร์แบซ์ของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ในสารละลายที่มีคลอ ไรค์ผสม ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า", วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
- Adibi, F. and et al. (1993).Design and characterization of a compact two-target ultrahigh vacuum magnetron sputter deposition system: Application to the growth of epitaxial Ti_{1-x}Al_xN alloys and TiN/Ti_{1-x}Al_xN superlattices. Journal of Vacuum Science & Technology A11.136-142.
- Ahn, S.H. and et al. (2002). A study on corrosion resistance characteristics of PVD Cr-N coated steels by electrochemical method. <u>Surface and Coatings Technology</u>.150.319-326.
- Bhola S.M. and Mishra B. (2013). Effect of pH on the Electrochemical Properties of Oxides formed over β Ti-15Mo and Mixed Ti-6Al-4V Alloys. International Journal of Electrochemical Science. 8, 7075-7087.
- Bouzakis, K.-D.and et al. (2004). Wear behavior of PVD coated tools with respect to annealing treatments. <u>Tribology in industry</u>. 26. 2-14.
- Chakrabarti, K. and et al. (2002). Effects of nitrogen flow rates on the growth morphology of TiAlN films prepared by an rf-reactive sputtering technique. <u>Thin Solid Films</u>.406. 159-163.
- Chawa, V. and et al. (2009). Corrosion behavior of nanostructured TiAlN and AlCrN hard coatings on Superfer 800H superalloy in simulated marine environment. Journal of minerals & <u>Materials Characterization & Engineering</u>.8. No. 9.693-700.
- Chen, J.Y., Yu, G.P. and Huang, J.H. (2000). Corrosion behavior and adhesion of ion-plated TiN films on AISI 304 steel. <u>Materials Chemistry and Physics</u>. 65. 310-315
- Cheng-Hsun, H., Jung-kai, L., Kuei-Liang, L. and Ming-Li, C. (2005). Erosion and corrosion behaviors of ADI deposited TiN/TiAlN coatings by cathodic arc evaporation. <u>Materials</u> <u>Transactions</u>. 46. 1417-1424.

- Christine, T. and Alan, R.P. (2005).Effect of Temperature and pH on the Corrosion resistance of nitinol.<u>In : Proceeding of ASM Materials &Processes for Medical Divices Conference</u>. California.
- Crocombette, J.P., Pollak, M., Jollet, F., Thromat, N., Gautier-Soyer, M. (1994). X-ray-absorption spectroscopy at the Fe $L_{2,3}$ threshold in iron oxides. <u>Physical Review B</u>. 52:3143-3150.
- Cunha, L. and et al. (1999).Corrosion of CrN and TiAlN coatings in chloride-containing atmospheres.Surface and Coatings Technology. 116-119. 1152-1160.
- Einstein, A. (1905). Ann. Physik. 17. pp. 132.
- Esaka, F., Furuya, K., Shimada, H., Imamura, M., Matsubayashi, N., Sat, T., Nishijima, A., Kikuchi, T., Kawana, A. and Ichimura, H. (1997). XAS Study on the Intermediate Species Formed During the Surface Oxidation of CrN Films. <u>Journal de Physique IV</u>. C2- 1149-C2-1150.
- Fontana, M. G. (1987). <u>Corrosion Engineering</u>.3rd Edition, McGraw-Hill Book Company. Singapore.
- Frazer, B.H., Gilbert, B., Songderegger, B.R. and Stasio, G.D. (2003). The probing depth of total electron yield in the sub-keV range: TEY-XAS and X-PEEM, *Surface Science*. 537. 161-167.
- Gaute, S. Corrosion of Aluminium Alloys. http://www.Sintefno/static/mt/norlight/seminars/norlight 2003/postere/Gaute%20 svenningsen.pdf.
- Guiot, E., Wu, Z.Y., Gota, S., Gautier-Soyer, M. (1999). Polarized O K edge spectra of Fe₂O₃ (0001) nanometric films: A full multiple scattering interpretation. <u>Journal of Electron</u> <u>Spectroscopy and Related Phenomena</u>.101-103.371-375.
- Hernandez S.E. and et al. (1995). The effect of thickness on the corrosion susceptibility of Al thinfilm metallizations. Journal of the electrochemical society. 142. 1215-1220.
- Hocking, R.K., Wasinger, E.C., Groot, F.M.F., Hodgson, K.O., Hedman, B. and Solomon, E.I. (2006). Fe L Edge XAS Studies of K₄[Fe(CN)₆] and K₃[Fe(CN)₆]: A Direct Probe of Back-Bonding, <u>Journal of the American Chemical Society</u>. 128. 10442-10451.
- Huang, J.-H., Ouyang, F.-Y.and Yu, G.-P. (2007). Effect of film thickness and Ti interlayer on the structure and properties of nanocrystalline TiN thin films on AISI D2 steel. <u>Surface and</u> <u>Coatings Technology</u>. 201. 7043–7053.

- Jehn, H.A. (2000). Improvement of the corrosion resistance of PVD hard-coating-substrate systems. <u>Surface and Coatings Technology</u>. 125. 212-217.
- Kim, C.W. and Kim, K.H. (1997). Anti-oxidation properties of TiA1N film prepared by plasmaassisted chemical vapor deposition and roles of A1. <u>Thin Solid Films</u>. 307. 113–119.
- Korablov, S., Basavalingu, B. and Yoshimura, M. (2005). Wet corrosion of nitride PVD films in supercritical solutions. <u>Corrosion science</u>.47. 1384-1402.
- Linna, R. (2012). High temperature behavir of arc evaporated ZrAlN and TiAlN thoin films. Linkoping University, Sweden.
- Liscano, S., Gil, L., Leon, O.A., Cruz, M. and Staia, M. H. (2006).Corrosion performance of duplex treatments based on plasma nitriding and PAPVD TiAlN coating. <u>Surface and Coatings Technology</u>. 201. 4419-4423
- Liu, C and et al. (1995). An a.c impedance study on PVD- coated mild steel with different surface roughness. <u>Surface and Coatings Technology</u>.76-77(part2).623-631.
- Lunarska, E., Ageeva, N. and Michalski, J. (1996). Corrosion resistance of plasma-assisted chemical vapour deposition (PACVD) TiN-coated steel in range of aggressive environments. <u>Surface and Coatings Technology</u>. 85. 125-130.
- Mazhar, A.A., Arab, S.T. and Noor, E.A. (2001). The Role of chloride ions and pH the corrosion and pitting of Al-Si alloy. Journal of Applied Electrochemistry. 31. 1131-1140.
- Patel, N.S. and et al. (2010).Corrosion behavior of Ti2N thin films in various corrosive environments. Journal of Materials and Environmental Science. 1. 34-43.
- Preda, I., Soriano, L., Gutierrez, A., Palacin, S., Fernandez-Garcia, M., Belver, C., Gonzalez-Diaz, N., Vollmer, A., Bressler, P.R., and Sanz J.M. (2005). Electronic structure of TiO₂ nanoparticles as observed by X-ray absorption spectroscopy (XAS). <u>2ndNanoSpain</u> <u>Workshop</u>. Barcelona.
- Rober, G. t. 1998. Tool Steels. 5th Edition, Materials Park. OH: ASM International.
- Sedriks, A. J. (1996). Corrosion of Stainless Steels. 2nd Edition, John-Wiley & Sons. New York.
- Schedel-Niedrig, Th. (1998). X-Ray absorption spectroscopy: sensitive characterization of (model-) catalysts with the electron yield technique, Fresen. <u>Journal of Analytical Chemistry</u>. 361. 680-682.
- Shew, B.Y., Huang, J.L. and Lii, D.F. (1997). Effects of r.f. bias and nitrogen flow rates on the reactive sputtering of TiAlN films. <u>Thin Solid films</u>. 293. 212-219.

- Souto, R. M. and Alanyali, H. (2000). Electrochemical characteristics of steel coated with TiN and TiAlN coatings. <u>Corrosion science</u>.42. 2201-2211.
- Wasinger, E.C., Groot, F.M.F., Hedman, B., Hodgson, K.O. and Solomon, E.I. (2003). L-edge Xray Absorption Spectroscopy of Non-Heme Iron Sites: Experimental Determination of Differential Orbital Covalency, Journal of the American Chemical Society. 125. 12894-12906.
- Wongpinij, T. and et al. (2012). The oxidation behaviour of stainless steel AISI 409 coated by decorative nickel-chromium plating. Journal of Metals, Material and Minerals. 22. 45-54.
- Xu L.Y. and et al., 2013 Electrochemical Behavior of Corrosion Resistance of X65/Inconel 625 Welded Joints. International Journal of Electrochemical Science. 8. 2069 – 2079.
- Yoon, W.S., Kim, K.B., Kim, M.G., Lee, M.K., Shin, H.J., Lee, J.M., Lee, J.S. and Yo, C.H. (2002). Oxygen contribution on Li- ion intercalation-deinterealation in LiCoO₂ investigated by OK-edge and Co L-edge X- ray absorption spectroscopy, <u>The Journal of Physical Chemistry B</u>, 106, 2526-2532.



ภาคผนวก ก

แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS-card



Aluminum Titanium Nitride (1/1/2)2 (AITi)N2 Radiation=CuKa1 Lambda=1.5406 Filter= Calibration= 2T=37.135-62.662 1/1c(RIR)=3.6 Ref: Calculated from Fl2#608638(03/10/09) by Jade Cubic,Fm3m (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0> P.S= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid NOTE: Fl2#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", lkeda, T.Statoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNT1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (Information taken from Single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 2 2 2 2.0970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 2 2 2 1 1.4828 52.8<	P I=	PDF # 97 -060-8638: QM=Calculated; d=Calculated; l=(Unknown)						PDF Ca	ard						
(AITi)N2 Radiation=CuKa1 Lambda=1.5406 Filter= Calibration= 2T=37.135-62.662 1/lc(RIR)=3.6 Ref: Calculated from FiZ#608638(03/10/09) by Jade Z=2 Cubic,Fm3m Z=2 (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19x4.19 90.0x90.0x90.0x90.0x P.5= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid NOTE: FIZ#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AbxTTi-X, se0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (Information taken from fig are). Metals composition/sof details M= AI,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hki) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 2 2.0970 100.0 200 4.31.92 4.23.95 2.33	A	luminum	Titaniu	ım Nitrio	de (1/1/2))2		_	-						
Radiation=CuKa1 Lambda=1.5406 Filter= Calibration= 2T=37.135-62.662 I/ic(RIR)=3.6 Ref: Calculated from Fi2#608638(03/10/09) by Jade Z=2 Cubic,Fm3m Z=2 (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0	(4	AlTi)N2													
Calibration= 2T=37.135-62.662 I/Ic(RIR)=3.6 Ref: Calculated from FIZ#608638(03/10/09) by Jade Z=2 Cubic,Fm3m (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0x90.0	Radiation=CuKa1							1	Filter=						
Calibration= 21=37.133-62.662 (FIC(NIR)=3.6 Ref: Calculated from FiZ#608638(03/10/09) by Jade Z=2 Cubic,Fm3m (225) CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0x90.0x	-	Lambua=1.5406						Ther-							
Ref: Calculated from FiZ#608638(03/10/09) by Jade Cubic,Fm3m (225) CELL: 4.19x4.19x4.19 Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid NOTE: FIZ#608638: "Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 Image: Align: A		Calibration= 2T=37.135-62.662								K)=3.b					
Cubic,Fm3m (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0> P.5= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid Image: Comparison of the trial of trial of the trial of tr	R	ef: Calcul	ated fr	om FIZ#	608638(0	3/10/09) by Jade								
Cubic, Fm3m (225) Z=2 CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0> P.S= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 Ref: Ibid NOTE: FiZ#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.;Satoh, H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (Information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al, Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # $d(A)$ I(f) (hkl) 2- Theta $1/(2d)$ # $d(A)$ I(f) (hkl) 2- 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 2 2 20970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 2 2 2 2 2 22.956 31.298 0.3372 2 2 2 2 2 2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>															
(225) CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0> P.S= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid NOTE: FIZ#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Solata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al, Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) I(f) Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 Image: Computer C	C	ubic,Fm3	m					Г				Z=2			
CELL: 4.19x4.19x4.19 <90.0x90.0x90.0x90.0x P.S= Density(c)=4.6 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 32 Ref: Ibid Image: Strength of the strengt of the strength of the strength of the stre	(2	25)													
Density(c)=4.6 32 Density(m)= Mwt= Vol=73.8 Ref: Ibid Image: Stress of the stress of	C	ELL: 4.19	x4.19x4	1.19 <90	.0x90.0x9	>0.0		Π			P.S=				
32 Ref: Ibid NOTE: FI2#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065	D	ensity(c)	=4.6	Dens	ity(m)=	N	Mwt≂	Vo	ol=7	3.8	-	1-			
Ref: IbidNOTE: FIZ#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", Ikeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper.Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/53 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = ()# $d(A)$ $I(f)$ (hkl) 2 Theta1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 a a 2 2.0970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 a a a 3 1.4828 52.8 (220) 62.956 31.298 0.3372 a a a	3	32													
NOTE: FIZ#608638: " Phase formation and characterization of hard coating in the Ti-Al-N system prepare by the cathodic arc ion pting method", lkeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper.Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/53 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = ()#d(A)12.42142.421448.0112.42142.0970100.0(200)43.10221.5510.238431.482852.8(220)62.95631.2980.3372	R	ef: Ibid						1		À.					
prepare by the cathodic arc ion pting method", lkeda, T.;Satoh,H., Thin Solid Film. V195 (1991) 99-110, Metals Sdata Record: INT=count; APP=diffractometer. Metals Solute Record: AlxNTi1-x, x=0.07, a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sof details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065	N	OTE: FIZ#	60863	8: " Pha	se format	tion and	character	rizat	ion	of ha	rd coat	ing in th	e Ti-Al-N	system	
Metals Suite Record. IN F-count Acoust, AFF-contractometer. Metals Solute Record. AXXIII: A, X=0.07,a=0.4259-0.4168 nm, linear dependence, (information taken from fig are). Metals composition/sofdetails M= Al, Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in thepaper. At least one temperature factor missing in the paper.Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/53 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = ()# $d(A)$ I(f)(hkl)2.20970100.0(200)43.1022.0970100.0(200)43.10221.5510.238431.482852.8(220)62.95631.2980.3372	p	repare by	the ca	thodic a	rc ion pti	ng meth	od", lked	da, T	.;Sa	atoh,H	I., Thin	Solid Fil	m. V195 ((1991) 99 -0.07	9-110,
details M= Al,Ti. Structure type: NaCl. X-ray diffraction from single crystal \N. No R value given in the paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) l(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) l(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065	a	=0.4259-(0.4168	nm, line	ar depen	dence, (informati	on t	ake	en fror	n fig ar	e). Meta	als compo	sition/se	of
paper. At least one temperature factor missing in the paper. Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065	d	etails M=	Al,Ti. S	tructure	e type: Na	Cl. X-ray	diffractio	on f	ron	n singl	e crysta	al \N. No	o R value	given in	the
Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 BEIMAUA 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 Image: Colspan="4">Image: Colspan="4" Image:	p	aper. At l	east on	e tempe	erature fa	ictor mis	sing in th	e pa	ape	r.	10				
Strong Lines: 2.10/X 1.48/5 2.42/5 3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>SUL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					5	15				20	SUL				
3 Lines Wavelength to compute Theta = 1.54059A(Cu), 1%-Type = () # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 0.2065 0.2084 <	St	rong Line	es: 2.10	/X 1.48/	/5 2.42/5	<u>908</u>	าลัยเท	คโเ	ſ	194					
# d(A) I(f) (hkl) 2- Theta Theta 1/(2d) # d(A) I(f) (hkl) 2- Theta Theta 1/(2d) 1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 1/(2d) Theta 1/(2d) 1/(2d) 1/(2d) Theta 1/(2d)	3	Lines Wa	veleng	th to co	mpute Th	eta = 1.5	54059A(C	iu), 1	1%-	Type =	= ()				
Image: Constraint of the state of the s	#	d(A)	I(f)	(hkl)	2-	Theta	1/(2d)		#	d(A)	I(f)	(hki)	2-	Theta	1/(2d)
1 2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 2 2.0970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 3 1.4828 52.8 (220) 62.956 31.298 0.3372		-(,		,	Theta		-/ (/			-1.1		(,	Theta		
2.4214 48.0 (111) 37.098 18.549 0.2065 2.0970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 3 1.4828 52.8 (220) 62.956 31.298 0.3372	1								Ц						
2 2.0970 100.0 (200) 43.102 21.551 0.2384 3 1.4828 52.8 (220) 62.956 31.298 0.3372	1	2.4214	48.0	(111)	37.098	18.549	0.2065								
3 1.4828 52.8 (220) 62.956 31.298 0.3372	2	2.0970	100.0	(200)	43.102	21.551	0.2384								
	3	1.4828	52.8	(220)	62.956	31.298	0.3372								

ตารางที่ ก.1 JCPDS-card ของสารประกอบ TiAlN₂ (Ti_{0.5}Al_{0.5}N)

ตารางที่ ก.2 JCPDS-card ของสารประกอบ Fe

Pattern : 00-001-1267		Radiation = 1.54	40600
Fe		2th	i
		45.068 65.186	100 15
Iron		82.352 99.401	38 10
		117.716 136.273	3
			3
Lattice : Body-centered cubic	Mol. weight = 55.85		
S.G.: Im-3m (229)	Volume [CD] = 23.41		
a = 2.86070	Dx = 7.922		
Z = 2			
		ļ ļ	
Deleted and rejected by: Deleted by NBS card.			
Melting point: 1539			
Data collection flag: Ambient.			
l Andrew Andr			
/ / ·			
Hanawalt. et al., Anal. Chem., volume 10, page 475 (1938)			
5			
15	Value		
ากยา	ເລັບເກດໂນໂລຍີຊີ ³		
]	
Radiation : MoKa Filte	er: Beta]	
Lambda : 0.70900 d-sj	p: Not given		
SS/FOM: F7= 6(0.1640,7)		I	

Pattern : 39-1420		Radiation =	1 5400	00		
TIN		2th	1	•	*	,
Titonium Nitr de Osbom-tel svn		36.663 42.597 61 814 74.070 77.964 93.173 104.677 108 611 125.676 141.320	72 100 45 19 12 5 6 14 12 7	1223243445	1 2 1 2 0 3 2 2 1	-00+00-00-
Lattice : Face-centered cubic	Mol. weight = 61.91					
S.G. : Fm-3m (225)	Volume [CD] = 76 32					
a = 4 24173	Dx = 5.380					
Z = 4						
Additional pattern: To reclace 6-842 : Analysis: No impurity found by SERI w (EDS) Structure: The structure was determin Data collection flag: Ambient	2) th Energy Dispersive Spectrometer ed by Christensen (1) 25 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76	SUL ST				
Wong-Ng W., McMurdie, H., Paretzkin Gannersourg, MD, USA., ICDD Grant-i CAS Number 12033-66-8	. B., Hubbard C., Dragoo, A., NBS. n-Aid (1997)					
Redistion : CuKa1	Filter : Monachromator crystal					
Lambda : 1.54000	d-sp : Diffractometer					
SS/FOM : F10=176(0.0057,10)	Internal standard . St					

ตารางที่ ก.3 JCPDS-card ของสารประกอบ TiN

ภาคผนวก ข

การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และการคำนวณอัตราการกัดกร่อน



การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{corr}), ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{corr}) และค่าอัตราการกัดกร่อน (R_{mpy}) โดยประมวลผลจากรูปของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน ของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ที่ไม่เคลือบผิว (A4140) และ ชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไน ตรายด์ (TiAIN-250nm, TiAIN-500nm และ TiAIN-750nm)



รูปที่ ข.1 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Tafel จะทำให้ได้จุดตัดของ ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{cor}) และ ค่าความ หนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{cor}) ดังแสดงในรูปที่ ข.1 ซึ่งค่าที่ได้นี้จะถูกนำไปใช้ในการ กำนวณหาค่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานต่อไป การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ที่ไม่ถูกเคลือบผิว และ ชิ้นงานเหล็กกล้าAISI4140 ที่ถูกเคลือบผิวด้วยฟิล์ม ไทเทียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์

การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนสามารถหาได้จากการนำค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า การกัดกร่อนที่อ่านได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน, น้ำหนักสมมูลของโลหะ และความหนาแน่นของ โลหะ แทนลงในสมการที่ ข.1 โดยค่าอัตราการกัดกร่อนที่กำนวณได้จะแสดงผลในหน่วยมิลลิเมตร ต่อปี

(1.1)

 $R_{mm/year} = (0.00327 * I_{corr} * e) / \rho$

โดยที่ R_{mm/year} คือ อัตราการเกิดการกัดกร่อน (มิลลิเมตรต่อปี) I_{cor} คือ ก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (ไมโครแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร) e คือ น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ ρ คือ กวามหนาแน่นของโลหะ (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

ร₇₁₅กยาลัยเทคโนโลยีสุรับ

ตัวอย่างในการคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI 4140 ที่ถูก ทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่ มีค่าพีเอชเท่ากับ 2



รูปที่ ข.2 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

จากรูปที่ ข.2 การวิเคราะห์แบบ Tafel จะทำให้ได้จุดตัดของ ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{cor}) และ ค่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{cor})

โดย

ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{cor})
เท่ากับ -1020 มิลลิโวลต์
ก่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{cor})
เท่ากับ 6 ไมโครแอมป์/ตารางเซนติเมตร
น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ (e)
เท่ากับ 26.62 กรัม
กวามหนาแน่นของโลหะ (ρ)
เท่ากับ 7.87 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
เมื่อนำค่าที่ได้มาคำนวณหาอัตราการกัดกร่อน โดยแทนค่าลงในสมการที่ ข.1 โดยค่าอัตราการกัด

R_{mm/year} = (0.00327 * 6 * 26.62) / 7.87 = 0.0663 มิถลิเมตรต่อปี ตัวอย่างในการคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า AISI4140 ที่ถูกเคลือบ ผิวด้วยฟิล์ม ไทเทียม-อะลูมิเนียม-ในตรายด์ ที่ถูกทดสอบการกัดกร่อนในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 3.5 โดยน้ำหนักที่มีค่าพีเอชเท่ากับ 2



รูปที่ ข.3 การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน และ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

จากรูปที่ ข.3 การวิเคราะห์แบบ Tafel จะทำให้ได้จุดตัดของ ก่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{cor}) และ ก่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (I_{cor})

โดย

ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (E_{corr}) ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน

เท่ากับ -720 มิลลิโวลต์ เท่ากับ 3.5 ไมโครแอมป์/ตารางเซนติเมตร

การคำนวณน้ำหนักกรัมสมมูลย์ของชั้นเคลือบ TiAIN (ASTM G102-89, 1999)

ตารางที่ ข.1 ส่วนผสมเคมีของชั้นเคลือบ ไทเทเนียม-อะลูมิเนียม-ไนตรายค์(เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)

ชั้นเคลือบ TiAlN	ไทเทเนียม (Ti)	อะลูมิเนียม (Al)	ในโตรเจน (N)
(เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)	33.53	6.74	59.73
เลขออกซิเคชั่น	5+	3+	4+

Electron equivalent (Q) สำหรับ 1 กรัมของชั้นเคลือบ TiAlN

$$Q = \sum \frac{\text{nifi}}{\text{Wi}}$$

โดยที่ ni คือ เวเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุนั้นๆ ในโลหะผสม fi คือ สัคส่วนน้ำหนักของของธาตุนั้นๆ ในโลหะผสม Wi คือ น้ำหนักอะตอมของธาตุนั้นๆ ในโลหะผสม

Q= $\frac{33.53}{14.007}$ x 5 + $\frac{6.74}{26.981}$ x 3 + $\frac{59.73}{47.8674}$ x 5 =17.709 กรัม

น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะผสม (e) 100/17.709 เท่ากับ 5.65 กรัม

น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ (e) เท่ากับ 5.65 กรัม ความหนาแน่นของโลหะ (ρ) เท่ากับ 4.81 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

เมื่อนำค่าที่ได้มาคำนวณหาอัตราการกัดกร่อน โดยแทนค่าลงในสมการที่ ข.1 โดยค่าอัตรา การกัดกร่อนที่กำนวณได้แสดงผลในหน่วยมิลลิเมตรต่อปี

> R_{mm/year} = (0.00327 * 3.5 * 5.65) / 4.81 = 0.0134 มิลลิเมตรต่อปี

ภาคผนวก ค

ส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

ร_{ัสวอักยาลัยเทคโนโลยีสุร}บไร

รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

 Thipusa Wongpinij, Pornwasa Wongpanya, Chanan Euaruksakul, Pat Photongkam, Nirun Witit-anun. Corrosion Behavior of TiAlN film on AISI 4140 Steel, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 23, No. 2, December (2013), pp. 59-65.



ประวัติคณะผู้วิจัย

 นางสาวพรวสา วงศ์ปัญญา สำเร็จการศึกษา Doktor-Ingenieur in Mechanical Engineering จาก Helmut-Schmidt-Universität, Germany เมื่อปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 300000

 นายนิรันคร์ วิทิตอนันต์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

นายชนรรค์ เอื้อรักสกุล สำเร็จการศึกษา Ph.D. in Electrical and Computer Engineering
จาก University of Wisconsin – Madison ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการระบบลำเลียงแสง
BL3.2b: PEEM สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000

